(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-330297 (P2000-330297A)

(43)公開日 平成12年11月30日(2000.11.30)

(51) Int.Cl. ⁷	微別記号	FI	テーマコード(参考)
G03F 7/32		G03F 7/32	
C08G 73/10		C 0 8 G 73/10	
C08K 5/28		C08K 5/28	
C08L 79/08		C08L 79/08	Α
G03F 7/004	501	G03F 7/004	5 0 1
	審查請求		
(21)出願番号	特膜2000-66836(P2000-66836)	(71)出膜人 000003	078
		株式会	社束芝
(22)出顧日	平成12年3月10日(2000.3.10)	神奈川	県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者 川門前	
(31)優先権主張番号	特願平11-69112	神奈川	県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
(32)優先日	平成11年3月15日(1999.3.15)		東芝研究開発センター内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者 早瀬	
		神奈川	県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
			東芝研究開発センター内
		(74)代理人 100058	479
		弁理士	鈴江 武彦 (外6名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感光性ポリイミド用現像液、ポリイミド膜パターン形成方法、及び電子部品

(57)【要約】

【課題】 感光性ポリイミドの解像特性及び残膜特性を 大幅に改善する現像液を提供する。

【解決手段】 25 ℃における水溶液中の塩基解離指数 $p K b が 5 \sim 8$ のアミン化合物の水溶液からなることを 特徴とする感光性ポリイミド用現像液である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 25℃における水溶液中の塩基解離指数 pKbが5~8のアミン化合物の水溶液からなる現像 液。

【請求項2】 (I) ポリイミド前駆体と感光性溶解抑止剤とを含むポジ型感光性ポリイミド溶液を基板表面に塗布し、加熱して樹脂層を形成する工程と、(III)前記樹脂層の所望の領域を露光する工程と、(III)前記露光後の樹脂層を、25℃における水溶液中の塩基解離指数 p K b が 5 ~ 8 のアミン化合物の水溶液からなる現像液で現像する工程と、(IV)前記現像後の樹脂層に熱処理を施す工程とを具備するポリイミド膜パターン形成方法。

【請求項3】 前記ポリイミド前駆体が、下記一般式 (1)で表される反復単位を有する請求項3に記載のポ リイミド膜パターン形成法。

【化1】

(但し、式中、

φは、置換もしくは非置換の、炭素数 1 ~ 3 0 の脂肪族 炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基また は複素環基、並びに、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水 素基、芳香族炭化水素基または複素環基が直接または架 橋基により相互に連結された化合物基からなる群より選 ばれた 4 価の有機基を示す。Ψは、置換もしくは非置換 の、炭素数 1 ~ 3 0 の脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水 素基、芳香族炭化水素基または複素環基、並びに、脂肪 族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環基が直接または裸橋基により相互に連結され たは複素環基が直接または架橋基により相互に連結され た化合物基からなる群より選ばれた 2 価の有機基を示 す。mは、正の整数を示す。)

【請求項4】 前記感光性溶解抑止剤が、下記一般式(2)~(5)で表されるナフトキノンジアジド化合物のうち少なくとも1種である請求項2または3に記載のポリイミド膜パターンの形成方法。

【化2】

$$(Q-Z)_{1}$$

$$(T)_{n}$$

$$(T)_{n}$$

$$(Z-Q)_{k}$$

$$(Q-Z)_{1}$$

$$(T \xrightarrow{\mathbf{n}} \mathbf{n})_{\mathbf{n}} \cdots (5)$$

(但し、式中、

Qはそれぞれ同一でも異なっていても良く、水素基、 1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホニル 基または1、2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-ス ルホニル基を示し、式中の少なくとも1個のQは1, 2 ーナフトキノンー2ージアジドー4ースルホニル基また は1,2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニ ル基である。Rはそれぞれ同一でも異なっていても良 く、水素基、置換もしくは非置換の、脂肪族炭化水素 基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環 基を示す。Tはそれぞれ同一でも異なっていても良く、 置換もしくは非置換の、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化 水素基、芳香族炭化水素基または複素環基を示す。Xは それぞれ同一でも異なっていても良く、オキシ基、チオ 基、スルホニル基、カルボニル基、メチレン基、エチリ デン基、2, 2-プロピリデン基、1, 1, 1, 3, $3, 3-\Lambda$ キサフルオロ-2, 2-プロピリデン基、1-フェニル-1, 1-エチリデン基、1, 1-シクロへ キシリデン基または9,9-フルオレニリデン基を示 す。Zはそれぞれ同一でも異なっていても良く、オキシ 基またはイミノ基を示す。jは、0~3の整数を示し、 kはそれぞれ同一でも異なっていても良く1~3の整数

を示し、n はそれぞれ同一でも異なっていても良く $0\sim4$ の整数を示す。)

【請求項5】 請求項3に記載のポリイミド膜パターン 形成方法により得られるポリイミド膜パターンを少なく とも絶縁部材、保護膜部材、液晶素子部材または光学素 子部材として具備することを特徴とする電子部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、絶縁部材、保護膜部材、液晶素子部材、光学素子部材などに用いられる、感光性ポリイミドのパターン形成において、残膜特性及び解像特性を大幅に改善する感光性樹脂用の現像液に関する。また、各種電子部品の絶縁膜、保護膜、α線遮断膜、光導波路などに用いられる、解像性、耐熱性、密着性に優れたポリイミドパターン膜を得ることが可能なパターン形成方法に関する。また、前記パターン形成方法を用いた電子部品に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置においては、素子を外部環境の影響から保護し、その信頼性を高める目的で、素子が形成された半導体基板表面上に保護膜(パッシベーション膜)を設ける処理がなされている。一般的に、前記保護膜の材料としては、絶縁性などの電気特性、耐放射線性、環境安定性及び耐熱性に優れたポリイミド樹脂が広く用いられている。また、半導体装置のα線遮断膜、多層配線構造素子や多層積層構造素子(マルチチップモジュール)における層間絶縁膜としても、前記特性によりポリイミド樹脂が広く使用されている。

【0003】上記のようなポリイミド樹脂は、その前駆体であるポリアミド酸から容易に膜形成させることが可能である。即ち、先ず前記ポリアミド酸のワニスを所定の表面に塗布し、これを低温加熱することによってポリアミド酸の膜を形成する。更に、この膜に対して高温加熱処理を行い、前駆体であるポリアミド酸を脱水環化反応により硬化させ、ポリイミド膜を形成する。この方法は、各種有機溶媒に不溶または難溶であり、かつ軟化点が高温で加工が困難であるポリイミド樹脂の膜を容易に形成できるため、広く行われている。

【0004】一方、半導体装置においては、多層配線構造におけるスルーホール、及び外部リードとの導通を行うためのパッド加工などが必要とされている。従って、該半導体装置において保護膜または層間絶縁膜として形成されたポリイミド膜をパターニングすることにより、所定のパターン構造を有する穴や溝を形成することが必要とされている。

【0005】通常、ポリイミド膜のパターニングは、フォトレジストを使用したPEP(photoengraving process)によって行われている。即ち、素子が形成された半導体基板表面上に前記方法によりポリイミド膜を形成した後、その表面上に更にフォ

トレジスト膜を設け、このフォトレジスト膜を露光・現像してレジストパターンを形成する。そして、このレジストパターンを耐エッチングマスクとして、下地のポリイミド膜の選択エッジングを行うことにより、所望のパターンを有するポリイミド保護膜または層間絶縁膜などを形成する。

【0006】しかし、上記方法によって、ポリイミド膜パターンを形成する場合、ポリイミド膜の形成とパターン形成のためのPEPとを独立した2つの工程で行うことが必要となり、多段階工程による作業の煩雑化が生じていた。

【0007】このような工程面での欠点を解消するために、PEPを使用せずにポリイミド膜のパターニングを可能にするポリイミド前駆体を含む樹脂組成物が、これまでに開示されている。

【0008】例えば、ポジ型の感光性能を有する感光性 樹脂組成物として、特開昭第52-13315号公報及 び特開昭第62-135824号公報にポリイミド前駆 体に感光剤として0-キノンジアジド化合物を添加した 組成物がそれぞれ開示されている。

【0009】これらの感光性樹脂組成物は、ポリイミド前駆体(ポリアミド酸)に感光剤(感光性溶解抑止剤)を添加してなり、これらの感光性樹脂組成物を用いてポリイミド膜パターンを形成するには、前記感光性樹脂組成物の溶液を基板表面に塗布後乾燥して樹脂層を形成後、露光現像してパターン形成し、その後樹脂層に熱処理を行い、ポリイミド前駆体を脱水環化反応により硬化(イミド化)させる。

【0010】これらの感光性樹脂組成物は、アルカリ現像液によって現像処理ができ、従来感光性ポリイミド用のアルカリ現像液としては、フォトレジスト材料のアルカリ現像液として一般に広く使用されている無機アルカリ(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなど)及び有機アルカリ(テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、コリン、トリエチルアミン、エタノールアミン、ジエチルエタノールアミンなど)の水溶液が用いられてきた。

【0011】これらの無機アルカリ及び有機アルカリは塩基解離指数pKbが4.5以下(即ちプロトン錯体の酸解離指数pKaが9.5以上)と塩基性が非常に強い化合物である。これらの無機アルカリ及び有機アルカリの水溶液は、感光性ポリイミドの溶解速度が非常に早いため0.05mol/L以下の希薄溶液で使用されている。

【0012】しかしながらこのような従来の感光性ポリイミド用現像液を用いると、解像特性及び残膜特性が非常に悪いという問題点があった。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】本発明は前記問題点を 鑑みて為されたものであり、感光性ポリイミドの解像特 性及び残膜特性を大幅に改善する現像液を提供することを目的とする。

【0014】また本発明は、フォトレジストを別途使用することなく、解像性及び残膜特性に優れたポリイミド膜パターンを形成することができる、パターン形成方法を提供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、25 における水溶液中の塩基解離指数 pKbが $5\sim8$ のアミン化合物の水溶液からなる現像液が提供される。

【0016】また本発明によれば、25℃における水溶液中の塩基解離指数pKbが5~8の置換または非置換のNー置換イミダゾールの水溶液からなる現像液が提供される。

【0017】さらに本発明によれば、(I)ポリイミド前駆体と感光性溶解抑止剤とを含むポジ型感光性ポリイミド溶液を基板表面に塗布し、加熱して樹脂層を形成する工程と、(III)前記樹脂層の所望の領域を露光する工程と、(III)前記露光後の樹脂層を、25℃における水溶液中の塩基解離指数pKbが5~8のアミン化合物の水溶液からなる現像液で現像する工程と、(IV)前記現像後の樹脂層に熱処理を施す工程とを具備するポリイミド膜パターン形成方法が提供される。

【0018】本発明の現像液は、感光性ポリイミド用として好ましく用いることができる。

【0019】前記ポリイミド膜パターン形成法で用いられる前記ポリイミド前駆体は、下記一般式(1)で表される反復単位を有するポリアミド酸であることが望ましい。

[0020]

【化3】

【0021】(但し、式中、ゆは、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂肪族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂環式炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の複素環基、並びに、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環基が直接または架橋基により相互に連結された化合物基からなる群より選ばれた4価の有機基を示す。

【0022】Ψは、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂肪族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂環式炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の複素環基、並びに、脂肪族炭化水素

基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環 基が直接または架橋基により相互に連結された化合物基 からなる群より選ばれた2価の有機基を示す。

【0023】mは、正の整数を示す。)

前記ポリイミド前駆体としては、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、メチレンー 4, 4'-ジフタル酸二無水物、1,1-エチリデンー 4, 4'ージフタル酸二無水物、2, 2ープロピリデン -4,4'-ジフタル酸二無水物、1,1,1,3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2, 2-プロピリデン-4, 4'ージフタル酸二無水物、オキシー4,4'ージフタ ル酸二無水物、チオー4,4'ージフタル酸二無水物、 スルホニルー4,4'ージフタル酸二無水物、1,3-3-テトラメチルジシロキサン二無水物、9-フェニル 6, 7-テトラカルボン酸二無水物及び9, 9-ビス (トリフルオロメチル) キサンテン-2, 3, 6, 7-テトラカルボン酸二無水物から選ばれる少なくとも1種 のジフタル酸二無水物誘導体を0.6モル当量以上含む テトラカルポン酸二無水物成分1.0モル当量;オキシ -3, 3'-ジアニリン、オキシ-3, 4'-ジアニリ ン、オキシー4、4'ージアニリン、スルホニルー3、 3'ージアニリン、スルホニルー4,4'ージアニリ ン、メチレン-3,3'-ジアニリン、メチレン-4、 4'ージアニリン、2,2ープロピリデン-3,3'-ジアニリン、2,2-プロピリデン-4,4'-ジアニ リン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2 - プロピリデン - 3, 3' - ジアニリン、1, 1,1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-プロピリデ ン-4, 4'-ジアニリン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-プロピリデン-5, 5'-ジ (2-トルイジン)、1,1,1,3,3,3-ヘキサ フルオロー2,2ープロピリデンー4,4'ービス(2 -アミノフェノール)から選ばれる少なくとも1種のジ アニリン誘導体を0.6モル当量以上含むジアミン化合 物 0. 8~1. 2モル当量;および1, 3-ビス(3-アミノプロピル) -1, 1, 3, 3-テトラメチルジシ ロキサン、1,5-ビス(3-アミノプロピル)-1, 1, 3, 3, 5, 5-ヘキサメチルトリシロキサン、 1, $7 - \forall \lambda$ (3 - $\gamma \in J$) $\gamma = 1$, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7ーオクタメチルテトラシロキサン、 1, 11-ビス (3-アミノプロピル)-1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11ードデカメチ ルヘキサシロキサンから選ばれる少なくとも1種のシロ キサン化合物 0.02~0.2モル当量を、有機溶媒中 で反応させて合成したポリアミド酸であることが特に望 ましい。

【0024】前記ポリイミド膜パターン形成法で用いられる前記感光性溶解抑止剤は、フェノール化合物または

アニリン化合物とナフトキノンジアジドスルホニルクロ リド化合物を反応させて得られる、ナフトキノンジアジ ドスルホン酸エステル化合物またはナフトキノンジアジ ドスルホン酸アミド化合物であることが望ましい。

【0025】前記感光性溶解抑止剤としては、下記一般式(2) \sim (5) で表されるナフトキノンジアジド化合物のうち少なくとも1種であることが特に望ましい。

[0026]

$$(Q-Z)_{j}^{(T)_{n}} \times (T)_{n}^{(T)_{n}} \cdots (4)$$

$$(T \xrightarrow{a} 0 0 (T)_{a} \dots (5)$$

【0027】(但し、式中、Qはそれぞれ同一でも異なっていても良く、水素基、1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホニル基または1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニル基を示す。ただし、式中の少なくとも1個のQは、1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホニル基、または1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニル基である。

【0028】Rはそれぞれ同一でも異なっていても良く、水素基、置換もしくは非置換の脂肪族炭化水素基、置換もしくは非置換の脂環式炭化水素基、置換もしくは非置換の芳香族炭化水素基、または置換もしくは非置換の複素環基を示す。

【0029】Tはそれぞれ同一でも異なっていても良

く、置換もしくは非置換の脂肪族炭化水素基、置換もしくは非置換の脂環式炭化水素基、置換もしくは非置換の 芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の複素環基を示す。

【0030】 Xは、オキシ基、チオ基、スルホニル基、カルボニル基、メチレン基、エチリデン基、2, 2-プロピリデン基、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2, 2-プロピリデン基、1-フェニル-1, 1-エチリデン基、1, 1-シクロヘキシリデン基、または1, 1-ファニル・1-フルオレニリデン基を示す。

【0031】Zは、オキシ基またはイミノ基を示す。

【0032】 jは0~3の整数を示し、kはそれぞれ同一でも異なっていても良く1~3の整数を示し、nはそれぞれ同一でも異なっていても良く0~4の整数を示す。) また、本発明によれば、前記ポリイミド膜パターン形成方法により得られるポリイミド膜パターンを少なくとも絶縁部材、保護膜部材、液晶素子部材または光学素子部材として具備する電子部品が提供される。

【0033】本発明は、感光性ポリイミドのベースポリマーとして使用されるポリイミド前駆体(ポリアミド酸)のカルボキシル基の酸解離指数pKaが3.5~4.5と低いことに着目してなされたものである。本発明の感光性ポリイミド用現像液を用いれば、未溶解部のポリイミド前駆体(ポリアミド酸)のカルボキシル基と溶解抑止剤との相互作用を阻害せずに、かつ溶解部のポリアミド酸を速やかに溶解できる。

【0034】すなわち、本発明の25℃における水溶液中の塩基解離指数pKbが5~8(プロトン錯体の酸解離指数pKaが6~9)のアミン化合物または環状アミン化合物を用いた現像液は、ポリアミド酸のカルボキシル基とナフトキノンジアジド化合物などの感光性溶解抑止剤との会合(相互作用)を阻害せずポリアミド酸と感光性溶解抑止剤の会合体を保持することができる。これと同時に、露光部において光反応により感光性溶解抑止剤が分解して溶解抑止能を失活した部分のポリアミド酸を選択的に溶解除去できるため、未溶解部でほとんど膜を侵食しないまま、溶解部を速やかに溶解除去できる。

【0035】したがって、感光性ポリイミド膜パターン 形成をするにあたり、現像工程で、本発明の現像液を使 用することにより、未溶解部の膜をほとんど侵食させる こと無く溶解部を速やかに溶解し、高解像かつ高残膜率 の微細なポリイミド膜パターンを形成することができ る。

【0036】尚、本発明に該当しない塩基解離指数 p K b が 5 未満(プロトン錯体の酸解離指数 p K a が 9 を越える)のアミン化合物を使用した現像液は、その塩基性が強すぎてポリアミド酸のカルボキシル基と感光性溶解抑止剤の相互作用を阻害してポリアミド酸と感光性溶解抑止剤との会合体を加水分解してしまう。このため、未溶解部で大きく膜を侵食してしまい、感光性ポリイミド

の解像性及び残膜特性が大幅に低下する。また、本発明に該当しない塩基解離指数 p K b が 8 を越える(プロトン錯体の酸解離指数 p K a が 6 未満)のアミン化合物を使用した現像液は、その塩基性が弱すぎてポリアミド酸を溶解除去することができない。このため、感光性ポリイミドのパターン形成をすることができない。

[0037]

【発明の実施の形態】以下、本発明の現像液について説明する。

【0038】本発明の感光性ポリイミド用現像液は、25℃における水溶液中の塩基解離指数pKbが5~8のアミン化合物の水溶液からなる。

【0039】水溶液中におけるアミン化合物Aの塩基解離定数Kb、アミン化合物のプロトン錯体HA+の酸解離定数、および水のイオン積Kwは、以下の関係式で表される。

[0040]

【数1】

$$Kb = \frac{[HA^+] \cdot [OH^-]}{[A]}$$

$$Ka = \frac{[H^+] \cdot [A]}{[HA^+]}$$

$$Kw = [H^+] \cdot [OH^+] = Ka \cdot Kb$$

[0042]

(Kb:塩基解離定数、Ka:プロトン錯体の酸解離定数、pKa:プロトン錯体の酸解離指数=-log(Ka)、Kw:水のイオン積)

25℃の水溶液における水のイオン積Kwは 1×10 $^{-14}$ $(m \circ 1^2/L^2)$ であるので、25℃における塩基解離指数pKbは以下のとおり表される。

[0043] pKb=14-pKa

25℃における水溶液中の塩基解離指数pKbが5~8のアミン化合物とは、言い換えれば、25℃における水溶液中のプロトン錯体の酸解離指数pKaが6~9のアミン化合物である。

【0044】本発明において現像液に用いられるアミン化合物は、25℃における水溶液中の塩基解離指数 pK bが5~8(すなわち25℃における水溶液中のプロトン錯体の酸解離指数 pKaが6~9)のアミン化合物で

ある。特に、25℃における水溶液中のpKbが6~7(すなわち25℃における水溶液中のプロトン錯体のpKaが7~8)のアミン化合物が好ましい。こうしたアミン化合物を含有する現像液は、解像特性及び残膜特性がより優れているためである。

【0045】本発明に係る25℃における水溶液中のpKbが5~8のアミン化合物とは、25℃における水溶液中のpKbが5~8の環状アミン化合物あるいは非環状アミン化合物を示す。具体的には、置換もしくは非置換のイミダゾール、置換もしくは非置換のモルホリン、置換もしくは非置換のピロリン、置換もしくは非置換のN-(2-シアノエチル)ピペラジン、置換もしくは非置換のN-プロパルギルピペラジン、置換もしくは非置換のN-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン、置換もしくは非置換のプロパギルアミン、置換もしくは非置換のプロパギルアミン、置換もしくは非置換のプロパギルアミン、置換もしくは非置換のプロパギルアミン、は非置換のジエタノールアミン、および置換もしくは非置換のドリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンなどが挙げられる。

【0046】前述の環状アミン化合物または非環状アミン化合物に導入される置換基としては、例えば、下記(A)群の脂肪族炭化水素基、下記(B)群の脂環式炭化水素基、下記(C)群の芳香族炭化水素基、下記

(D) 群の複素環基、下記(a) 群の特性基、脂肪族炭化水素基を下記(a) 群の特性基で置換した置換脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基を下記(a) 群の特性基で置換した置換脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基を下記(a) 群の特性基で置換した置換芳香族炭化水素基、および複素環基を下記(a) 群の特性基で置換した置換複素環基が挙げられる。

【0047】(A)脂肪族炭化水素基

メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、 sec.-ブチル基、tert.-ブチル基、ペンチル基、tert.-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ビニル基、アリル基、イソプロペニル基、プロペニル基、メタリル基、クロチル基、ブテニル基、ペンテニル基、ブタジエニル基、エチニル基、プロピニル基、ブチニル基、およびペンチニル基などから選ばれる少なくとも一種。

【0048】(B)脂環式炭化水素基

シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基、シクロヘプテニル基、シクロオクテニル基、シクロペンタジエニル基、およびシクロヘキサジエニル基などから選ばれる少なくとも一種。

【0049】(C)芳香族炭化水素基

ベンゼン環基、ナフタレン環基、アントラセン環基、フェナントレン環基、テトラリン環基、アズレン環基、ピ

フェニレン環基、アセナフチレン環基、アセナフテン環基、フルオレン環基、トリフェニレン環基、ピレン環基、クリセン環基、ピセン環基、ペリレン環基、ベンゾピレン環基、ルビセン環基、コロネン環基、オバレン環基、インデン環基、ペンタレン環基、ヘプタレン環基、インダセン環基、フェナレン環基、アセフェナントリレン環基、アセアントリレン環基、アセフェナントリレン環基、アセアントリレン環基、ナフタセン環基、プレイアデン環基、ペンタフェン環基、ペンタセン環基、トリナフチレン環基、ヘプタフェン環基、ヘプタセン環基、およびピラントレン環基などから選ばれる少なくとも一種。

【0050】(D)複素環基

ピロール環基、ピロリン環基、ピロリジン環基、インド ール環基、イソインドール環基、インドリン環基、イソ インドリン環基、インドリジン環基、カルバゾール環 基、カルボリン環基、フラン環基、オキソラン環基、ク マロン環基、クマラン環基、イソベンゾフラン環基、フ タラン環基、ジベンゾフラン環基、チオフェン環基、チ オラン環基、ベンゾチオフェン環基、ジベンゾチオフェ ン環基、ピラゾール環基、ピラゾリン環基、インダゾー ル環基、イミダゾール環基、イミダゾリン環基、イミダ ゾリジン環基、ベンゾイミダゾール環基、ベンゾイミダ ゾリン環基、ナフトイミダゾール環基、オキサゾール環 基、オキサゾリン環基、オキサゾリジン環基、ベンゾオ キサゾール環基、ベゾオキサゾリン環基、ナフトオキサ ゾール環基、イソオキサゾール環基、ベンゾイソオキサ ゾール環基、チアゾール環基、チアゾリン環基、チアゾ リジン環基、ベンゾチアゾール環基、ベンゾチアゾリン 環基、ナフトチアゾール環基、イソチアゾール環基、ベ ンゾイソチアゾール環基、トリアゾール環基、ベンゾト リアゾール環基、オキサジアゾール環基、チアジアゾー ル環基、ベンゾオキサジアゾール環基、ベンゾチアジア ゾール環基、テトラゾール環基、プリン環基、ピリジン 環基、ピペリジン環基、キノリン環基、イソキノリン環 基、アクリジン環基、フェナントリジン環基、ベンゾキ ノリン環基、ナフトキノリン環基、ナフチリジン環基、 フェナントロリン環基、ピリダジン環基、ピリミジン環 基、ピラジン環基、ピペラジン環基、フタラジン環基、 キノキサリン環基、キナゾリン環基、シンノリン環基、 フェナジン環基、ペリミジン環基、トリアジン環基、テ トラジン環基、プテリジン環基、オキサジン環基、ベン ゾオキサジン環基、フェノキサジン環基、チアジン環 基、ベンゾチアジン環基、フェノチアジン環基、オキサ ジアジン環基、チアジアジン環基、ジオキソラン環基、 ベンゾジオキソール環基、ジオキサン環基、ベンゾジオ キサン環基、ジチオラン環基、ベンゾジチオール環基、 ジチアン環基、ベンゾジチアン環基、ピラン環基、クロ メン環基、キサンテン環基、オキサン環基、クロマン環 基、イソクロマン環基、トリオキサン環基、チアン環

基、トリチアン環基、モルホリン環基、キヌクリジン環基、セレナゾール環基、ベンゾセレナゾール環基、ナフトセレナゾール環基、テルラゾール環基、およびベンゾテルラゾール環基などから選ばれる少なくとも一種。 【0051】(a)特性基

ジ置換アミノ基(ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ 基、ジブチルアミノ基、エチルメチルアミノ基、ブチル メチルアミノ基、ジアミルアミノ基、ジベンジルアミノ 基、ジフェネチルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジト リルアミノ基、ジキシリルアミノ基、メチルフェニルア ミノ基、ベンジルメチルアミノ基など)、モノ置換アミ ノ基(メチルアミノ基、エチルアミノ基、プロピルアミ ノ基、イソプロピルアミノ基、tert.-ブチルアミノ基、 アニリノ基、アニシジノ基、フェネチジノ基、トルイジ ノ基、キシリジノ基、ピリジルアミノ基、チアゾリルア ミノ基、ベンジルアミノ基、ベンジリデンアミノ基な ど)、環状アミノ基(ピロリジノ基、ピペリジノ基、ピ ペラジノ基、モルホリノ基、1-ピロリル基、1-ピラゾリ ル基、1-イミダゾリル基、1-トリアゾリル基など)、ア シルアミノ基(ホルミルアミノ基、アセチルアミノ基、 ベンゾイルアミノ基、シンナモイルアミノ基、ピリジン カルボニルアミノ基、トリフルオロアセチルアミノ基な ど)、スルホニルアミノ基(メシルアミノ基、エチルス ルホニルアミノ基、フェニルスルホニルアミノ基、ピリ ジルスルホニルアミノ基、トシルアミノ基、タウリルア ミノ基、トリフルオロメチルスルホニルアミノ基、スル ファモイルアミノ基、メチルスルファモイルアミノ基、 スルファニルアミノ基、アセチルスルファニルアミノ基 など)、アミノ基、ヒドロキシアミノ基、ウレイド基、 セミカルバジド基、カルバジド基、ジ置換ヒドラジノ基 (ジメチルヒドラジノ基、ジフェニルヒドラジノ基、メ チルフェニルヒドラジノ基など)、モノ置換ヒドラジノ 基(メチルヒドラジノ基、フェニルヒドラジノ基、ピリ ジルヒドラジノ基、ベンジリデンヒドラジノ基など)、 ヒドラジノ基、アミジノ基、オキシム基(ヒドロキシイ ミノメチル基、メトキシイミノメチル基、エトキシイミ ノメチル基、ヒドロキシイミノエチル基、ヒドロキシイ ミノプロピル基など)、ヒドロキシ基、オキシ基(メト キシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ヒド ロキシエトキシ基、フェノキシ基、ナフトキシ基、ピリ ジルオキシ基、チアゾリルオキシ基、アセトキシ基な ど)、チオ基(メチルチオ基、エチルチオ基、フェニル チオ基、ピリジルチオ基、チアゾリルチオ基など)、ア ルコキシアルキル基(ヒドロキシメチル基、ヒドロキシ エチル基、ヒドロキシプロピル基など)、シアノ基、シ アナト基、チオシアナト基、ニトロ基、ニトロソ基、メ ルカプト基、ハロゲン基(フルオロ基、クロロ基、プロ モ基、ヨード基)、カルボキシル基及びその塩、オキシ カルボニル基(メトキシカルボニル基、エトキシカルボ ニル基、フェノキシカルポニル基、ピリジルオキシカル

ボニル基など)、アミノカルボニル基(カルバモイル 基、メチルカルバモイル基、フェニルカルバモイル基、 ピリジルカルバモイル基、カルバゾイル基、アロファノ イル基、オキサモイル基、スクシンアモイル基など)、 チオカルボキシル基及びその塩、ジチオカルボキシル基 及びその塩、チオカルポニル基(メトキシチオカルボニ ル基、メチルチオカルボニル基、メチルチオチオカルボ ニル基など)、アシル基(ホルミル基、アセチル基、プ ロピオニル基、アクリロイル基、ベンゾイル基、シンナ モイル基、ピリジンカルボニル基、チアゾールカルボニ ル基、トリフルオロアセチル基など)、チオアシル基 (チオホルミル基、チオアセチル基、チオペンゾイル 基、ピリジンチオカルボニル基など)、スルフィン酸基 及びその塩、スルホン酸基及びその塩、スルフィニル基 (メチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、フェ ニルスルフィニル基など)、スルホニル基(メシル基、 エチルスルホニル基、フェニルスルホニル基、ピリジル スルホニル基、トシル基、タウリル基、トリフルオロメ チルスルホニル基、スルファモイル基、メチルスルファ モイル基、スルファニリル基、アセチルスルファニリル 基など)、オキシスルホニル基(メトキシスルホニル 基、エトキシスルホニル基、フェノキシスルホニル基、 アセトアミノフェノキシスルホニル基、ピリジルオキシ スルホニル基など)、チオスルホニル基(メチルチオス ルホニル基、エチルチオスルホニル基、フェニルチオス ルホニル基、アセトアミノフェニルチオスルホニル基、 ピリジルチオスルホニル基など)、アミノスルホニル基 (スルファモイル基、メチルスルファモイル基、ジメチ ルスルファモイル基、エチルスルファモイル基、ジエチ ルスルファモイル基、フェニルスルファモイル基、アセ トアミノフェニルスルファモイル基、ピリジルスルファ モイル基など)、アンモニオ基(トリメチルアンモニオ 基、エチルジメチルアンモニオ基、ジメチルフェニルア ンモニオ基、ピリジニオ基、キノリニオ基など)、アゾ 基(フェニルアゾ基、ピリジルアゾ基、チアゾリルアゾ 基など)、アゾキシ基、ハロゲン化アルキル基(クロロ メチル基、プロモメチル基、フルオロメチル基、ジクロ ロメチル基、ジブロモメチル基、ジフルオロメチル基、 トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ヘプ タフルオロプロピル基など)、有機ケイ素基(シリル 基、ジシラニル基、トリメチルシリル基、トリフェニル シリル基など) などから選ばれる少なくとも一種。

【0052】本発明の感光性ポリイミド用現像液においては、アミン化合物として、第三アミン化合物を用いることがより好ましい。第三アミン化合物としては、置換もしくは非置換のNー置換イミダゾール、置換もしくは非置換のNー置換ピロリン、置換もしくは非置換のNー(2ーシアノエチル)ピペラジン、置換もしくは非置換のNープロパギルピペラジン、置換もしくは非置換のNー(2ーヒ

ドロキシエチル)ピペラジン、置換もしくは非置換の2 - (N, N-ジ置換アミノ)プロピオニトリル、置換もしくは非置換のN, N-ジ置換アミノプロパギルアミン、置換もしくは非置換のトリエタノールアミン、置換もしくは非置換のN-置換ジエタノールアミン、および置換もしくは非置換のN, N-ジ置換トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンなどから選ばれる少なくとも一種を用いることが特に好ましい。これらの第三級アミンを化合物を含有する現像液は、解像特性および残膜特性に優れているからである。

【0053】これらの化合物のN位の置換基としては、 前記(A)群の脂肪族炭化水素基、前記(B)群の脂環 式炭化水素基、前記(C)群の芳香族炭化水素基、前記 (D) 群の複素環基、前記 (a) 群の特性基、脂肪族炭 化水素基を前記(a)群の特性基で置換した置換脂肪族 炭化水素基、脂環式炭化水素基を前記(a)群の特性基 で置換した置換脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基を 前記(a)群の特性基で置換した置換芳香族炭化水素 基、および複素環基を前記(a)群の特性基で置換した 置換複素環基が挙げられる。特に、メチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチ ル基、 sec.-ブチル基、tert.-ブチル基、ペンチル基、 tert.-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、 ヘキシル基、イソヘキシル基、シクロペンチル基、シク ロヘキシル基、フェニル基、ヒドロキシメチル基、ヒド ロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基、ヒドロキシブ チル基などの炭素数が6以下の炭化水素基が望ましい。 【0054】また、N位以外を置換する置換基として は、前記(A)群の脂肪族炭化水素基、前記(B)群の 脂環式炭化水素基、前記(C)群の芳香族炭化水素基、 前記(D)群の複素環基、前記(a)群の特性基、脂肪 族炭化水素基を前記(a)群の特性基で置換した置換脂 肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基を前記(a) 群の特 性基で置換した置換脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素 基を前記(a)群の特性基で置換した置換芳香族炭化水 素基、および複素環基を前記(a)群の特性基で置換し た置換複素環基が挙げられる。

【0055】第三アミン化合物の具体例としては、N-メチルイミダゾール、N-エチルイミダゾール、N-エチルモルボリン、N-メチルモルボリン、N-エチルモルボリン、N-(ヒドロキシエチル) イミダゾール、N-メチルモルボリン、N-エチルモルボリン、N-(ヒドロキシエチル) プロピオニトリル、N, N-ジメチルアミノ) プロピオニトリル、N, N-ジメチルプロパギルアミン、N, N-ジエチルジエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミン、N, N-ジメチルトリス(ヒドロキシメチル) アミノメタン、N, N-ジメチルトリス(ヒドロキシメチル) アミノメタン、N, N-ジメチルトリス(ヒドロキシエチル) ピペラジン、N-エチルーN'-(ヒドロキシエチル) ピペラジン、N-エチルーN'-(ヒドロキシエチル) ピ

ペラジン、およびN- (ヒドロキシエチル) - N'-(ヒドロキシエチル) ピペラジンなどが望ましい。これ らの中でも、pKbが6~7の第三アミン化合物[N-置換イミダゾール化合物、N-置換モルホリン化合物、 2-(N, N-ジ置換アミノ)プロピオニトリル化合 物、N,N-ジ置換プロパギルアミン化合物及びトリエ タノールアミンなど]から選ばれる少なくとも一種が、 解像特性および残膜特性に特に優れているためより好ま しい。具体的には、N-メチルイミダゾール、N-エチ ルイミダゾール、N-(ヒドロキシエチル)イミダゾー ル、N-メチルモルホリン、N-エチルモルホリン、N – (ヒドロキシエチル)モルホリン、2 – (ジメチルア ミノ)プロピオニトリル、2-(ジエチルアミノ)プロ ピオニトリル、N, N-ジメチルプロパギルアミン、 N. N-ジエチルプロパギルアミン、トリエタノールア ミンなどが挙げられる。現像時の膜剥離が生じにくいこ となどから、N-置換イミダゾール化合物が最も好まし 41

【0056】本発明の感光性ポリイミド用の現像液は、前記のアミン化合物を水に溶解し、濃度が0.1~20wt%になるように調製することが望ましい。アミン化合物の濃度が20wt%を超えると、未溶解部で大きく膜を侵食して残膜特性が悪くなるおそれがある。一方、アミン化合物の濃度が0.1wt%未満の場合には、溶解部を十分に溶解除去することができなくなるおそれがある。なお、本発明の現像液におけるアミン化合物の濃度は、1~10wt%であることがより好ましい。

【0057】現像液を調製する水としては、パターン膜を形成するSiウェハーや基板などのイオン性不純物による汚染を防止するため、イオン交換樹脂などにより脱イオンした純水や超純水などが望ましい。

【0058】また、本発明の感光性ポリイミド用現像液は、現像液の浸透性の改善や溶解スピードの調整のために、必要に応じて、アルコール化合物、界面活性剤、無機アルカリ化合物(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなど)、有機アルカリ化合物(テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、コリン、トリエチルアミン、エタノールアミン、ジエチルエタノールアミンなど)または酸化合物(ホウ酸、リン酸、炭酸、オキシム化合物、スクシンイミド化合物、フタルイミド化合物など)などを前記現像液に添加しても良い。

【0059】本発明の現像液は、フェノール樹脂、ノボラック樹脂、ポリアクリル酸、ポリイミド前駆体(ポリアミド酸など)、ポリベンゾオキサゾール前駆体などのアルカリ可溶性樹脂に感光性溶解抑止剤を添加した感光性樹脂に使用することができる。特に、ポリイミド前駆体(ポリアミド酸)に感光性溶解抑止剤を添加した感光性ポリイミド用の現像液として有用である。

【0060】次に、本発明の現像液を用いたポリイミド

膜パターン形成方法について説明する。

【0061】本発明のポリイミド膜のパターン形成方法は、少なくとも下記(I)乃至(IV)の工程を行う。

【0062】(I)ポリイミド前駆体と感光性溶解抑止剤を含むポジ型感光性ポリイミド溶液を基板表面に塗布し、加熱して樹脂層を形成する工程、(II)前記樹脂層の所望の領域を露光する工程、(III)前記露光後の樹脂層を、前述の現像液で現像する工程、(IV)前記現像後の樹脂層に熱処理を施す工程である。

【0063】上記(1)の工程は、ポジ型感光性ポリイミドの溶液をスピンコート法などにより基板表面に塗布した後、ホットプレートによる加熱などにより好ましくは160℃以下の温度で加熱乾燥し、樹脂層を形成することにより行われる。加熱乾燥時の加熱温度は、通常70~130℃が望ましいが、現像時の溶解速度を調整するために、必要に応じて、130~180℃で加熱乾燥してポリイミド前駆体の一部をイミド化させてもよい。なお、加熱乾燥時の加熱時間は、通常0.5~60min程度で十分である。

【0064】前記(I)の工程で用いられるポジ型感光性ポリイミドの溶液におけるポリイミド前駆体としては、ポリアミド酸、ポリアミド酸エステル、またはこれらのポリアミド酸とポリアミド酸エステルとの混合物が挙げられる。具体的には、例えばテトラカルボン酸二無水物化合物とジアミン化合物とを有機溶媒中で反応させたポリアミド酸、ポリアミド酸のカルボキシル基を一部または全部を置換もしくは非置換のアルキル基やテトラヒドロピラニル基でエステル化したポリアミド酸エステル、またはこれらのポリアミド酸とポリアミド酸エステルの混合物が挙げられる。

【0065】特に、下記一般式(1)で表される反復単位を有するポリイミド前駆体(ポリアミド酸)を用いることが望ましい。

[0066]

【化5】

$$\begin{bmatrix} H & O & H \\ N - C & C - N - \Psi \\ HOOC & COOH \end{bmatrix}_{m}$$
...(1)

【0067】(但し、式中、Φは、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂肪族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂環式炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の複素環基、並びに、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環基が直接または架橋基により相互に連結された化合物基からなる群より選ばれた4価の有機基を示す。

【0068】 Ψは、置換もしくは非置換の炭素数1~3

0の脂肪族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂環式炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の複素環基、並びに、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環基が直接または架橋基により相互に連結された化合物基からなる群より選ばれた2価の有機基を示す。

【0069】mは、正の整数を示す。)

前記一般式(1)で表されるポリイミド前駆体(ポリアミド酸)は、下記一般式(6)で表されるテトラカルボン酸二無水物と、下記一般式(7)で表されるで表されるジアミン化合物成分とを有機溶媒中で反応させることにより合成できる。

[0070]

【化6】



【0071】(但し、式中、φは、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂肪族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂環式炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の複素環基、並びに、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環基が直接または架橋基により相互に連結された化合物基からなる群より選ばれた4価の有機基を示す。)

【化7】

$H_2N-\Psi-NH_2$...(7)

【0072】(但し、式中、Ψは、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂肪族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の脂環式炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の芳香族炭化水素基、置換もしくは非置換の炭素数1~30の複素環基、並びに、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環基が直接または架橋基により相互に連結された化合物基からなる群より選ばれた2価の有機基を示す。)

前記一般式(6)で表されるテトラカルボン酸二無水物としては、例えば、ピロメリト酸二無水物、3-フルオロピロメリト酸二無水物、3-(トリフルオロメチル)ピロメリト酸二無水物、3-(トリフルオロメチル)ピロメリト酸二無水物、3,6-ビス(トリフルオロメチル)ピロメリト酸二無水物、1,2,3,4-ベンゼンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2,2',3,3'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3,

3", 4, 4"ーテルフェニルテトラカルポン酸二無水 物、3,3"',4,4"'-クァテルフェニルテトラカル ボン酸二無水物、3,3"",4,4""-キンクフェニル テトラカルボン酸二無水物、2,2',3,3'ーピフ ェニルテトラカルボン酸二無水物、メチレン-4,4' -ジフタル酸二無水物、1,1-エチリデン-4,4' -ジフタル酸二無水物、2,2-プロピリデン-4, 4'-ジフタル酸二無水物、1,2-エチレン-4, 4'ージフタル酸二無水物、1,3-トリメチレンー 4, 4'ージフタル酸二無水物、1, 4ーテトラメチレ ン-4、4'ージフタル酸二無水物、1、5ーペンタメ チレン-4,4'-ジフタル酸二無水物、1,1,1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2, 2-プロピリデン-4, 4'ージフタル酸二無水物、ジフルオロメチレンー 4, 4'-ジフタル酸二無水物、1, 1, 2, 2-テト ラフルオロー1、2-エチレン-4、4'-ジフタル酸 二無水物、1,1,2,2,3,3-ヘキサフルオロー 1, 3-トリメチレン-4, 4'-ジフタル酸二無水 物、1,1,2,2,3,3,4,4-オクタフルオロ -1, 4-テトラメチレン-4, 4'-ジフタル酸二無 水物、1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5ーデカ フルオロー1, 5-ペンタメチレン-4, 4'ージフタ ル酸二無水物、オキシー4,4'ージフタル酸二無水 物、チオー4, 4'ージフタル酸二無水物、スルホニル -4,4'-ジフタル酸二無水物、1,3-ビス(3, 4-ジカルボキシフェニル)ペンゼン二無水物、1,4 - ビス (3, 4 - ジカルボキシフェニル) ベンゼン二無 水物、1,3-ビス(3,4-ジカルボキシフェノキ シ) ベンゼン二無水物、1,4-ビス(3,4-ジカル ボキシフェノキシ)ベンゼン二無水物、1,3-ビス [2-(3,4-ジカルボキシフェニル)-2-プロピ ル] ベンゼン二無水物、1,4-ビス[2-(3,4-ジカルボキシフェニル) -2-プロピル] ベンゼン二無 水物、ビス[3-(3,4-ジカルポキシフェノキシ) フェニル] メタン二無水物、ビス [4-(3,4-ジカ ルボキシフェノキシ)フェニル]メタン二無水物、2, 2-ビス[3-(3,4-ジカルボキシフェノキシ)フ ェニル] プロパン二無水物、2,2-ビス[4-(3, 4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル]プロパン二無 水物、2, 2-ビス[3-(3, 4-ジカルボキシフェ ノキシ) フェニル] -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサ フルオロプロパン二無水物、2,2-ビス[4-(3, 4 - ジカルボキシフェノキシ)フェニル] - 1, 1,1、3、3、3-ヘキサフルオロプロパン二無水物、ビ ス(3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジメチルシラン 二無水物、1,3-ビス(3,4-ジカルボキシフェニ ν) -1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン二無水物、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルボン酸二 無水物、1,4,5,8-ナフタレンテトラカルボン酸 二無水物、1,2,5,6ーナフタレンテトラカルポン

酸二無水物、3,4,9,10-ペリレンテトラカルボ ン酸二無水物、2,3,6,7-アントラセンテトラカ ルポン酸二無水物、1,2,7,8-フェナントレンテ トラカルボン酸二無水物、エチレンテトラカルボン酸二 無水物、1,2,3,4-プタンテトラカルボン酸二無 水物、1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸 二無水物、シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、 シクロヘキサン-1, 2, 3, 4-テトラカルボン酸二 無水物、シクロヘキサン-1,2,4,5-テトラカル ボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビシクロヘキシ ルテトラカルボン酸二無水物、カルボニルー4,4'-ピス(シクロヘキサン-1, 2-ジカルポン酸)二無水 物、メチレン-4,4'ービス(シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸) 二無水物、1,2-エチレン-4. 4'ーピス(シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸) 二無水物、1,1-エチリデン-4,4'-ビス(シク ロヘキサン-1,2-ジカルボン酸)二無水物、2,2 ープロピリデンー4, 4'ービス(シクロヘキサンー 1, 2-ジカルボン酸) 二無水物、1, 1, 1, 3, 4'ーピス(シクロヘキサン-1,2-ジカルボン酸) 二無水物、オキシー4,4'ーピス(シクロヘキサンー 1, 2-ジカルボン酸) 二無水物、チオー4, 4'-ビ ス(シクロヘキサン-1,2-ジカルボン酸)二無水 物、スルホニル-4,4'-ピス(シクロヘキサン-1, 2-ジカルボン酸) 二無水物、2, 2'-ジフルオ ロ-3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸 二無水物、5,5'-ジフルオロ-3,3',4,4' ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、6,6'ージ フルオロー3, 3', 4, 4'ービフェニルテトラカル ボン酸二無水物、2,2',5,5',6,6'-ヘキ サフルオロー3, 3', 4, 4'ーピフェニルテトラカ ルボン酸二無水物、2,2'-ビス(トリフルオロメチ ル) -3, 3', 4, 4'-ピフェニルテトラカルボン 酸二無水物、5,5'-ビス(トリフルオロメチル)-3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無 水物、6,6'-ビス(トリフルオロメチル)-3, 3', 4, 4'ーピフェニルテトラカルボン酸二無水 物、2,2',5,5'-テトラキス(トリフルオロメ チル) -3, 3', 4, 4'-ビフェニルテトラカルボ ン酸二無水物、2,2',6,6'-テトラキス(トリ フルオロメチル) -3, 3', 4, 4'-ピフェニルテ トラカルボン酸二無水物、5,5',6,6'-テトラ キス (トリフルオロメチル) -3, 3', 4, 4'-ビ フェニルテトラカルボン酸二無水物、2,21,5, 5', 6, 6'-ヘキサキス(トリフルオロメチル)-3, 3', 4, 4'ービフェニルテトラカルボン酸二無 水物、オキシー4, 4'ーピス(3-フルオロフタル 酸) 二無水物、オキシー4, 4'ーピス(5-フルオロ フタル酸) 二無水物、オキシー4, 4'ーピス(6-フ

ルオロフタル酸) 二無水物、オキシー4, 4'ービス (3, 5, 6-トリフルオロフタル酸) 二無水物、オキ シー4,4'ービス[3-(トリフルオロメチル)フタ ル酸] 二無水物、オキシー4, 4'ーピス[5-(トリ フルオロメチル) フタル酸] 二無水物、オキシー4. 4'ービス[6-(トリフルオロメチル)フタル酸]二 無水物、オキシー4, 4'ービス[3,5ービス(トリ フルオロメチル) フタル酸] 二無水物、オキシー4, 4'ービス[3,6ービス(トリフルオロメチル)フタ ル酸] 二無水物、オキシー4, 4'ービス[5, 6ービ ス(トリフルオロメチル)フタル酸]二無水物、オキシ -4,4'-ビス[3,5,6-トリス(トリフルオロ メチル) フタル酸] 二無水物、スルホニルー4, 4'ー ビス(3-フルオロフタル酸)二無水物、スルホニルー 4, 4'ーピス(5ーフルオロフタル酸)二無水物、ス ルホニルー4,4'ーピス(6-フルオロフタル酸)二 無水物、スルホニルー4,4'ーピス(3,5,6ート リフルオロフタル酸) 二無水物、スルホニルー4, 4' - ビス[3-(トリフルオロメチル)フタル酸] 二無水 物、スルホニルー4,4'ービス[5-(トリフルオロ メチル)フタル酸] 二無水物、スルホニルー4, 4'-ピス [6-(トリフルオロメチル) フタル酸] 二無水 物、スルホニルー4,4'ービス[3,5ービス(トリ フルオロメチル) フタル酸] 二無水物、スルホニルー 4, 4'-ビス[3,6-ビス(トリフルオロメチル) フタル酸] 二無水物、スルホニルー4, 4'ービス [5,6-ピス(トリフルオロメチル)フタル酸]二無 水物、スルホニルー4、4'ービス[3、5、6ートリ ス(トリフルオロメチル)フタル酸]二無水物、1. 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-プロピ リデン-4,4'-ビス(3-フルオロフタル酸)二無 水物、1, 1, 1, 3, 3 - 0 2-プロピリデン-4,4'-ビス(5-フルオロフタ ル酸) 二無水物、1,1,1,3,3,3-ヘキサフル オロー2, 2ープロピリデンー4, 4'ーピス(6-フ ルオロフタル酸) 二無水物、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロー2, 2ープロピリデンー4, 4'ービ ス(3,5,6-トリフルオロフタル酸)二無水物、 1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-プ ロピリデンー4, 4'ービス[3-(トリフルオロメチ ル) フタル酸] 二無水物、1,1,1,3,3,3-へ キサフルオロー2, 2ープロピリデンー4, 4'ービス [5-(トリフルオロメチル)フタル酸]二無水物、 1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-プ ロピリデンー4、4'ービス[6-(トリフルオロメチ ル) フタル酸] 二無水物、1,1,1,3,3,3-へ キサフルオロー2, 2ープロピリデンー4, 4'ービス [3,5-ビス(トリフルオロメチル)フタル酸]二無 水物、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2, 2ープロピリデンー4,4'ービス[3,6ービス(ト

リフルオロメチル)フタル酸] 二無水物、1, 1, 1, 3, 3, 3 - ヘキサフルオロ-2, 2 - プロピリデン-4, 4'-ビス [5, 6 - ビス (トリフルオロメチル) フタル酸] 二無水物、1, 1, 1, 3, 3, 3 - ヘキサフルオロ-2, 2 - プロピリデン-4, 4'-ビス [3, 5, 6 - トリス (トリフルオロメチル) フタル酸] 二無水物、9 - フェニル-9 - (トリフルオロメチル) キサンテン-2, 3, 6, 7 - テトラカルボン酸二無水物及びビシクロ [2, 2, 2] オクト-7 - エン-2, 3, 5, 6 - テトラカルボン酸二無水物は単独では、10073 これらのテトラカルボン酸二無水物は単独では、10073 これらのテトラカルボン酸二無水物は単独では、10073 これらのテトラカルボン酸二無水物は単独では、10073 これらのテトラカルボン酸二無水物は単独では、10073 に対した。

で用いてもよいし、2種以上混合して用いてもよい。 【0074】テトラカルポン酸二無水物は、全酸無水物 成分のうち0.8モル当量以上、好ましくは0.9モル 当量以上用いられる。この理由は、テトラカルポン酸二 無水物の配合量が少なすぎる場合には得られるポリイミ

ド樹脂の耐熱性が低下するためである。

【0075】前記一般式(7)で表されるジアミン化合 物としては、例えば、1,2-フェニレンジアミン、 1, 3-フェニレンジアミン、1, 4-フェニレンジア ミン、3,3'ージアミノビフェニル、3,4'ージア ミノビフェニル、4,4'-ジアミノビフェニル、3, 3"ージアミノテルフェニル、4,4"ージアミノテル フェニル、3,3"'-ジアミノクァテルフェニル、4, 4"'-ジアミノクァテルフェニル、3,3""-ジアミ ノキンクフェニル、4,4""-ジアミノキンクフェニ ル、オキシー3,3'-ジアニリン、オキシー4,4' ージアニリン、チオー3,3'ージアニリン、チオー 4, 4'-ジアニリン、スルホニルー3,3'-ジアニ リン、スルホニルー4、4'ージアニリン、メチレンー 3, 3'ージアニリン、メチレンー4, 4'ージアニリ ン、1,2-エチレン-3,3'-ジアニリン、1,2 ーエチレンー4,4'ージアニリン、1,1ーエチリデ ン-3,3'-ジアニリン、1,1-エチリデン-4, 4'ージアニリン、1、3ープロピリデンー3、3'ー ジアニリン、1、3-プロピリデン-4、4'-ジアニ リン、2,2-プロピリデン-3,3'-ジアニリン、 2, 2-プロピリデン-4, 4'ージアニリン、ジフル オロメチレン-3,3'-ジアニリン、ジフルオロメチ レン-4, 4'-ジアニリン、1, 1, 2, 2-テトラ フルオロー1、2-エチレン-3、3'-ジアニリン、 1, 1, 2, 2-テトラフルオロー1, 2-エチレンー 4, 4'-ジアニリン、2, 2, 2-トリフルオロー 1, 1-エチリデン-3, 3'-ジアニリン、2, 2, 2-トリフルオロー1、1-エチリデンー4、4'ージ アニリン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー 2, 2-プロピリデン-3, 3'-ジアニリン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-プロピ リデン-4, 4'ージアニリン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロ-1, 3-プロピレン-3, 3'-ジアニリン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフルオロ -1, 3-プロピレン-4, 4'-ジアニリン、1, 3 ービス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビ ス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス (3-アミノフェニルチオ) ベンゼン、1, 3-ピス (4-アミノフェニルチオ) ベンゼン、1, 3-ビス (3-アミノフェニルスルホニル) ベンゼン、1,3-ビス (4-アミノフェニルスルホニル) ベンゼン、1, 3-ピス [2-(3-アミノフェニル)-2-プロピ ル] ベンゼン、1、3-ビス[2-(4-アミノフェニ ル) -2-プロピル] ベンゼン、1,3-ビス[2- $(3-7 \le 1/7 \le 1) -1, 1, 1, 3, 3, 3-4$ キサフルオロー2ープロピル] ベンゼン、1,3ービス $[2-(4-r \leq 1/2 + 2/2 + 2/2 + 1, 1, 1, 3, 3, 3, 2/2 +$ 3-ヘキサフルオロ-2-プロピル] ベンゼン、1,4 ービス (3-アミノフェノキシ) ベンゼン、1, 4-ビ ス(4-アミノフェノキシ)ペンゼン、1,4-ビス (3-アミノフェニルチオ) ベンゼン、1, 4-ビス (4-アミノフェニルチオ) ベンゼン、1, 4-ビス (3-アミノフェニルスルホニル) ベンゼン、1,4-ビス (4-アミノフェニルスルホニル) ベンゼン、1, 4-ビス[2-(3-アミノフェニル)-2-プロピ ル] ベンゼン、1, 4-ビス[2-(4-アミノフェニ ル) -2-プロピル] ベンゼン、1,4-ビス[2- $(3-7 \le 17 \le 1) -1$, 1, 1, 3, 3, 3- \wedge キサフルオロー2ープロピル]ベンゼン、1,4ービス [2-(4-r)]/(2-r) [2-(4-r)]/(2-r) [2-(4-r)]/(2-r)3-ヘキサフルオロ-2-プロピル]ベンゼン、4, 4'ービス(3-アミノフェノキシ)ピフェニル、4, 4'ービス(4ーアミノフェノキシ)ピフェニル、ビス [4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]エーテル、ビ ス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]エーテル、 ピス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]スルホ ン、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]スル ホン、2, 2-ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フ ェニル]プロパン、2,2-ビス[4-(4-アミノフェ ノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4-(3 - アミノフェノキシ) フェニル] -1, 1, 1, 3,3, 3-ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[4- $(4-r \le 1/r \le 1+r \le 1/r \le 1/r$ 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、5-フルオロー 1, 3-フェニレンジアミン、2-フルオロー1, 4-フェニレンジアミン、2,5-ジフルオロ-1,4-フ ェニレンジアミン、2,4,5,6-ヘキサフルオロー 1, 3-フェニレンジアミン、2, 3, 5, 6-ヘキサ フルオロー1, 4-フェニレンジアミン、3, 3'-ジ アミノー5、5'ージフルオロビフェニル、4、4'ー ジアミノー2、2'ージフルオロビフェニル、4、4'

ージアミノー3, 3'ージフルオロビフェニル、3, 3'ージアミノー2, 2', 4, 4', 5, 5', 6, 6'-オクタフルオロビフェニル、4,4'-ジアミノ -2, 2', 3, 3', 5, 5', 6, 6'-オクタフ ルオロビフェニル、オキシー5,5'-ビス(3-フル オロアニリン)、オキシー4、4'ービス(2-フルオ ロアニリン)、オキシー4、4'ーピス(3ーフルオロ アニリン)、スルホニルー5、5'ービス(3-フルオ ロアニリン)、スルホニルー4、4'ーピス(2ーフル オロアニリン)、スルホニルー4、4'ービス(3-フ ルオロアニリン)、1、3-ビス(3-アミノフェノキ シ) -5-フルオロベンゼン、1,3-ビス(3-アミ ノー5-フルオロフェノキシ)ペンゼン、1,3-ビス (3-アミノ-5-フルオロフェノキシ) -5-フルオ ロベンゼン、5-(トリフルオロメチル)-1,3-フ ェニレンジアミン、2-(トリフルオロメチル)-1, 4-フェニレンジアミン、2,5-ビス(トリフルオロ メチル) -1, 4-フェニレンジアミン、2, 2'-ビ ス (トリフルオロメチル) -4, 4' -ジアミノビフェ ニル、3,3'-ビス(トリフルオロメチル)-4, 4'ージアミノビフェニル、オキシー5,5'ーピス [3-(トリフルオロメチル)アニリン]、オキシー 4, 4'-ビス[2-(トリフルオロメチル)アニリ ン]、オキシー4、4'ーピス[3-(トリフルオロメ チル) アニリン]、スルホニルー5,5'ーピス[3-(トリフルオロメチル) アニリン]、スルホニルー4, 4'ーピス[2-(トリフルオロメチル)アニリン]、 スルホニルー4,4'ービス[3-(トリフルオロメチ ル) アニリン]、1,3-ビス(3-アミノフェノキ シ) -5- (トリフルオロメチル) ベンゼン、1,3-ピス [3-アミノー5-(トリフルオロメチル)フェノ キシ] ベンゼン、1、3-ビス[3-アミノ-5-(ト リフルオロメチル)フェノキシ]-5-(トリフルオロ メチル) ベンゼン、3、3'ービス(トリフルオロメチ ル) -5, 5' -ジアミノビフェニル、ビス (3-アミ ノフェノキシ) ジメチルシラン、ビス (4-アミノフェ ノキシ) ジメチルシラン、1,3-ビス(3-アミノフ ェニル) -1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサ ン、1, 3-ピス(4-アミノフェニル)-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、メチレンジアミ ン、1,2-エタンジアミン、1,3-プロパンジアミ ン、1,4-プタンジアミン、1,5-ペンタンジアミ ン、1,6-ヘキサンジアミン、1,7-ヘプタンジア ミン、1,8-オクタンジアミン、1,9-ノナンジア ミン、1,10-デカンジアミン、1,2-ビス(3-アミノプロポキシ) エタン、1, 3-ジアミノシクロへ キサン、1,4-ジアミノシクロヘキサン、ビス(3-アミノシクロヘキシル)メタン、ビス(4-アミノシク ロヘキシル)メタン、1,2-ビス(3-アミノシクロ ヘキシル) エタン、1, 2-ピス(4-アミノシクロヘ キシル) エタン、2、2-ビス(3-アミノシクロヘキ シル)プロパン、2、2-ビス(4-アミノシクロヘキ シル)プロパン、ピス(3-アミノシクロヘキシル)エ ーテル、ピス(4 -アミノシクロヘキシル)エーテル、 ビス (3-アミノシクロヘキシル) スルホン、ビス (4 -アミノシクロヘキシル)スルホン、2,2-ビス(3 -アミノシクロヘキシル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-アミノシ クロヘキシル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフル オロプロパン、1、3-キシリレンジアミン、1、4-キシリレンジアミン、1,8-ジアミノナフタレン、 2, 7-ジアミノナフタレン、2, 6-ジアミノナフタ レン、2,5-ジアミノピリジン、2,6-ジアミノピ リジン、2,5-ジアミノピラジン、2,4-ジアミノ -s-トリアジン、1,3-ビス(アミノメチル)シク ロヘキサン、1,4-ビス(アミノメチル)シクロヘキ サン、1,4-ビス(3-アミノプロピルジメチルシリ ル) ベンゼン及び1、3-ビス(3-アミノプロピル) -1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサンなどが 挙げられる。

【0076】これらのジアミン化合物は単独で用いてもよいし、2種以上混合して用いてもよい。

[0077] ジアミン化合物は、全アミン化合物成分の うち0.8モル当量以上、好ましくは0.9モル当量以 上用いられる。この理由は、ジアミン化合物の配合量が 少なすぎる場合には得られるポリイミド樹脂の耐熱性が 低下するためである。

【0078】これらのジアミン化合物とともに、下記一般式(8)で表されるジアミン化合物、即ちビス(アミノアルキル)パーアルキルポリシロキサン化合物を併用してもよい。

[0079]

【化8】

$$H_2N - (CH_2)_q$$
 (Si-O) $\stackrel{R}{\longrightarrow}$ Si-(CH₂) $\stackrel{H}{\longrightarrow}$ HN₂ ...(8)

【0080】 (Rはそれぞれ同一でも異なっていてもよく、炭素数 $1\sim5$ のアルキル基を示し、q及びrは $1\sim10$ の整数であり、pは正の整数である。)

前記一般式(8)で表されるビス(アミノアルキル)パーフルオロポリシロキサン化合物としては、例えば、

1, $3-\forall X$ ($P \le J \lor F \lor W$) -1, 1, 3, $3-F \lor F \lor W$) -1, 1, 3, $3-F \lor W$) -1, 1, 3, $3-F \lor F \lor W$ 0 -1, 1, 3, $3-F \lor W$ 1, $3-\forall X$ 2, 1, $3-\forall X$ 3, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 1

ン、1, 3-ビス (5-アミノペンチル) -1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, <math>3-ビス (6)

- アミノヘキシル) - 1, 1, 3, 3 - テトラメチルジシロキサン、1,3-ビス(7-アミノヘプチル)-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ピス (8-アミノオクチル) -1, 1, 3, 3-テトラ メチルジシロキサン、1,3-ビス(10-アミノデシ ル) -1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、 1, 5-ビス (3-アミノプロピル) -1, 1, 3, 3, 5, 5~ヘキサメチルトリシロキサン、1, 7-ビ ス (3-アミノプロピル) - 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7-オクタメチルテトラシロキサン、1, 11-ビ ス (3-アミノプロピル) - 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11-ドデカメチルヘキサシロ キサン、1,15-ビス(3-アミノプロピル)-1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 1 3, 13, 15, 15-ヘキサデカメチルオクタシロキ サン、1, 19 - ビス (3 - アミノプロピル) - 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 1 3, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19-エイ コサメチルデカシロキサンなどが挙げられる。

【0081】前記一般式(8)で表されるビス(アミノアルキル)パーアルキルポリシロキサン化合物は、例えばガラス基板やシリコン基板などの半導体基板上へのポリイミド樹脂の密着性および接着性を向上させる効果を有する。これらの化合物は、全ジアミン成分のうち0.02~0.2モル当量混合して使用することが好ましい。これは、この様な化合物を配合することによって、得られるポリイミド樹脂の基板上への密着性及び接着性が向上するものの、過度の配合はポリイミド樹脂の耐熱性低下を招く恐れがあるためである。

【0082】更に、ポリアミド酸の重合度を制御するために、末端処理剤として、ジカルボン酸無水物またはモノアミン化合物を用いることができる。

【0083】使用し得るジカルボン酸無水物としては、 例えば、マレイン酸無水物、シトラコン酸無水物、ジメ チルマレイン酸無水物、エチルマレイン酸無水物、ジエ チルマレイン酸無水物、プロピルマレイン酸無水物、ブ チルマレイン酸無水物、クロロマレイン酸無水物、ジク ロロマレイン酸無水物、プロモマレイン酸無水物、ジブ ロモマレイン酸無水物、フルオロマレイン酸無水物、ジ フルオロマレイン酸無水物、(トリフルオロメチル)マ レイン酸無水物、ビス(トリフルオロメチル)マレイン 酸無水物、シクロブタンジカルボン酸無水物、シクロペ ンタンジカルボン酸無水物、シクロヘキサンジカルボン 酸無水物、テトラヒドロフタル酸無水物、エンドメチレ ンテトラヒドロフタル酸無水物、メチルテトラヒドロフ タル酸無水物、メチルエンドメチレンテトラヒドロフタ ル酸無水物、フタル酸無水物、メチルフタル酸無水物、 エチルフタル酸無水物、ジメチルフタル酸無水物、フル オロフタル酸無水物、ジフルオロフタル酸無水物、クロ ロフタル酸無水物、ジクロロフタル酸無水物、プロモフ

タル酸無水物、ジブロモフタル酸無水物、ニトロフタル酸無水物、2,3-ベンゾフェノンジカルボン酸無水物、3-インゾフェノンジカルボン酸無水物、3-フェノキシフタル酸無水物、4-フェノキシフタル酸無水物、4-フェニルスルホニル)フタル酸無水物、4-ビフェニルジカルボン酸無水物、3,4-ビフェニルジカルボン酸無水物、2,3-ナフタレンジカルボン酸無水物、1,8-ナフタレンジカルボン酸無水物、1,8-ナフタレンジカルボン酸無水物、1,8-ナフタレンジカルボン酸無水物、1,2-アントラセンジカルボン酸無水物、1,9-アントラセンジカルボン酸無水物、2,3-ピリジンジカルボン酸無水物、3,4-ピリジンジカルボン酸無水物、3,4-ピリジンジカルボン酸無水物などが挙げられる。

【0084】また、使用し得るモノアミン化合物として は、例えば、メチルアミン、エチルアミン、プロチルア ミン、ブチルアミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミ ン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、1-(3-アミ ノプロピル) -1, 1, 3, 3, 3-ペンタメチルジシ ロキサン、ビニルアミン、アリルアミン、グリシン、ア ラニン、アミノ酪酸、バリン、ノルバリン、イソバリ ン、ロイシン、ノルロイシン、イソロイシン、グルタミ ン、グルタミン酸、トリプトファン、アミノクロトン 酸、アミノアセトニトリル、アミノプロピオニトリル、 アミノクロトノニトリル、シクロプロピルアミン、シク ロプチルアミン、シクロペンチルアミン、シクロヘキシ ルアミン、シクロヘプチルアミン、シクロオクチルアミ ン、アミノアダマンタン、アミノベンゾシクロブタン、 アミノカプロラクタム、アニリン、クロロアニリン、ジ クロロアニリン、プロモアニリン、ジプロモアニリン、 フルオロアニリン、ジフルオロアニリン、ニトロアニリ ン、ジニトロアニリン、トルイジン、キシリジン、エチ ルアニリン、アニシジン、フェネチジン、アミノアセト アニリド、アミノアセトフェノン、アミノ安息香酸、ア ミノベンズアルデヒド、アミノベンゾニトリル、アミノ フタロニトリル、アミノベンゾトリフルオリド、アミノ スチレン、アミノスチルベン、アミノアゾベンゼン、ア ミノジフェニルエーテル、アミノジフェニルスルホン、 アミノベンズアミド、アミノベンゼンスルホンアミド、 アミノフェニルマレイミド、アミノフェニルフタルイミ ド、アミノピフェニル、アミノテルフェニル、アミノナ フタレン、アミノアクリジン、アミノアントラキノン、 アミノフルオレン、アミノフルオレノン、アミノピロリ ジン、アミノピペラジン、アミノピペリジン、アミノホ モピペリジン、アミノモルホリン、アミノベンゾジオキ ソール、アミノベンゾジオキサン、アミノピリジン、ア ミノピリダジン、アミノピリミジン、アミノピラジン、 アミノキノリン、アミノシンノリン、アミノフタラジ ン、アミノキナゾリン、アミノキノキサリン、アミノピ ロール、アミノイミダゾール、アミノピラゾール、アミ

ノトリアゾール、アミノオキサゾール、アミノイソオキサゾール、アミノチアゾール、アミノイソチアゾール、アミノインドール、アミノベンゾイミダゾール、アミノベンダゾール、アミノベンゾオキサゾール、アミノベンゾチアゾール、ベンジルアミン、フェネチルアミン、フェニルプロピリアミン、フェニルブチルアミン、ベンズヒドリルアミン、アミノエチルー1,3-ジオキソラン、アミノエチルピロリジン、アミノエチルピペラジン、アミノエチルピペリジン、アミノエチルモルホリン、アミノプロピルイミダゾール及びアミノプロピルシクロへキサンなどが挙げられる。

【0085】上述したようなジカルボン酸無水物及びモノアミン化合物の配合量は、用途、粘度等に応じて適宜選択することができるが、例えば、テトラカルボン酸二無水物またはジアミン化合物に対して0.02~0.4 モル当量程度とすることが好ましい。

【0086】前述の一般式(1)で表されるポリアミド 酸を合成する方法は特に限定されないが、不活性ガス雰 囲気において有機極性溶媒中で無水の条件下に重合させ る方法が好ましい。この反応時に用いられる有機極性溶 媒としては、例えば、N, N-ジメチルホルムアミド、 N. N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジエチルアセ トアミド、N, N-ジメトキシアセトアミド、N-メチ ルー2-ピロリドン、N-アセチル-2-ピロリドン、 N-ベンジル-2-ピロリドン、1,3-ジメチル-2 ーイミダゾリジノン、ヘキサメチルホスホルトリアミ ド、N-メチル-ε-カプロラクタム、N-アセチル- ϵ -カプロラクタム、1, 2 - ジメトキシエタン、1, 2-ジエトキシエタン、ビス(2-メトキシエチル)エ ーテル、ピス(2-エトキシエチル)エーテル、1,2 ービス(2ーメトキシエトキシ)エタン、ビス[2-(2-メトキシエトキシ) エチル] エーテル、1-アセ トキシー2-メトキシエタン、1-アセトキシー2-エ トキシエタン、(2-アセトキシエチル)(2-メトキ シエチル) エーテル、(2-アセトキシエチル) (2-エトキシエチル) エーテル、3-メトキシプロピオン酸 メチル、テトラヒドロフラン、1,3-ジオキサン、 1, 3-ジオキソラン、1, 4-ジオキサン、ピロリ ン、ピリジン、ピコリン、ジメチルスルホキシド、スル ホラン、アーブチロラクトン、炭酸プロピレン、フェノ ール、クレゾール、アセトン、メチルエチルケトン、メ チルイソプチルケトン、シクロヘキサノン、アセトニル アセトンなどが例示される。これらの有機溶剤は単独で 用いてもよいし、2種以上混合して用いてよい。

【0087】反応温度は、通常 $-20\sim100$ ℃、好ましくは $-5\sim30$ ℃である。反応圧力は特に限定されず、常圧で十分実施できる。反応時間はテトラカルボン酸二無水物の種類、反応溶媒の種類により異なり、通常 $1\sim24$ 時間で十分である。

【0088】この時得られるポリアミド酸は、0.5w

t%-N, N-ジメチルアセトアミド溶液のインヒーレント粘度が<math>0.3 (dL/g)以上、更には0.3 (dL/g)以上であることが好ましい。この理由は、ポリアミド酸のインヒーレント粘度が低すぎる、即ちポリアミド酸の重合度が低すぎる場合には、耐熱性の十分なポリイミド樹脂を得ることが出来なくなる恐れがあり、一方インヒーレント粘度が高すぎる、即ち重合度が高すぎる場合には、その取扱いが困難になるからである。

【0089】前記一般式(1)で表されるポリイミド前 駆体(ポリアミド酸)としては、以下に列挙するような テトラカルボン酸二無水物とジアミン化合物とを、有機 溶媒中で反応させて合成したポリアミド酸が好ましい。 【0090】テトラカルポン酸二無水物としては、ピロ メリト酸二無水物、3,3',4,4'-ベンゾフェノ ンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビ フェニルテトラカルボン酸二無水物、3,3",4, 4"ーテルフェニルテトラカルボン酸二無水物、メチレ ン-4,4'-ジフタル酸二無水物、1,1-エチリデ ン-4,4'-ジフタル酸二無水物、2,2-プロピリ デン-4,4'-ジフタル酸二無水物、1,1,1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2, 2-プロピリデンー 4, 4'-ジフタル酸二無水物、オキシー4, 4'-ジ フタル酸二無水物、チオー4,4'ージフタル酸二無水 物、スルホニルー4、4'ージフタル酸二無水物、1、 3 - ビス (3, 4 - ジカルボキシフェニル) - 1, 1,3, 3-テトラメチルジシロキサン二無水物、2, 3, 6, 7-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1, 4, 5, 8-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、9 -フェニル-9- (トリフルオロメチル) キサンテン-2, 3, 6, 7ーテトラカルボン酸二無水物および9, 9-ピス(トリフルオロメチル)キサンテン-2,3, 6, 7-テトラカルボン酸二無水物などが挙げられる。 【0091】また、ジアミン化合物としては、1,3-フェニレンジアミン、1,4-フェニレンジアミン、 3, 3'ージアミノビフェニル、3, 4'ージアミノビ フェニル、4,4'-ジアミノビフェニル、3,3"-ジアミノテルフェニル、4,4"-ジアミノテルフェニ ル、オキシー3,3'-ジアニリン、オキシー3,4' -ジアニリン、オキシー4,4'-ジアニリン、スルホ ニルー3,3'ージアニリン、スルホニルー4,4'ー ジアニリン、メチレン-3,3'-ジアニリン、メチレ ン-4,4'-ジアニリン、2,2-プロピリデン-3, 3'ージアニリン、2, 2ープロピリデンー4, 4'-ジアニリン、1,1,1,3,3,3-ヘキサフ ルオロー2, 2-プロピリデン-3, 3'ージアニリ ン、1、1、1、3、3、3-ヘキサフルオロー2、2 ープロピリデンー4,4'ージアニリン、1,1,1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-プロピリデンー 5, 5'ージ(2ートルイジン)、1, 1, 1, 3,

4'-ビス(2-アミノフェノール)、1,3-ビス ーアミノフェノキシ) ベンゼン、1,3-ビス[2-(3-アミノフェニル) -2-プロピル] ベンゼン、 1, 3-ビス[2-(4-アミノフェニル)-2-プロ ピル] ベンゼン、1, 4-ビス(3-アミノフェノキ シ) ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ) ベンゼン、1, 4-ビス[2-(3-アミノフェニル)]-2-プロピル] ベンゼン、1, 4-ビス[2-(4-アミノフェニル) -2-プロピル] ベンゼン、4,4' ービス (3-アミノフェノキシ) ビフェニル、4,4' ービス(4ーアミノフェノキシ)ピフェニル、ビス[4 - (3-アミノフェノキシ)フェニル]エーテル、ビス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]エーテル、 ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] スルホ ン、ピス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ス ルホン、2,2-ビス[4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、2,2-ビス[4-(4-アミノ フェノキシ)フェニル]プロパン、2、2-ビス「4- $(3-r \le 1/r \le 1/r$ 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス $[4 - (4 - 7 \le 1) \ge 1, 1, 1]$ 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、5-(トリ フルオロメチル) -1, 3-フェニレンジアミン、2, 2'-ビス(トリフルオロメチル)-4,4'-ジアミ ノビフェニル、3,3'-ビス(トリフルオロメチル) -4,4'-ジアミノビフェニル、オキシ-5,5'-ピス[3-(トリフルオロメチル)アニリン]、1,8 ージアミノナフタレン、2, 7ージアミノナフタレン、 2, 6-ジアミノナフタレン、1, 3-ビス(3-アミ ノプロピル)-1,1,3,3-テトラフェニルジシロ キサン、1,3-ビス(3-アミノプロピル)-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 5-ビス (3-アミノプロピル) -1, 1, 3, 3, 5, 5-ヘ キサメチルトリシロキサン、1,7~ビス(3-アミノ プロピル) -1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7-オクタメチルテトラシロキサン、1,11-ビス(3-アミノ プロピル) -1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11-ドデカメチルヘキサシロキサン、1, 15-ビス (3-アミノプロピル) -1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 1 5, 15-ヘキサデカメチルオクタシロキサン、1, 1 $9 - \forall \lambda (3 - \gamma \geq 1) \forall \alpha \forall \lambda (3 - \gamma \geq 1) = 1, 1, 3, 3, 3$ 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 1 5, 15, 17, 17, 19, 19-エイコサメチルデ カシロキサンなどが挙げられる。

【0092】特に、以下に示すようなテトラカルボン酸二無水物成分1.0モル当量と、ジアミン化合物0.8~1.2モル当量と、シロキサン化合物0.02~0.

2 モル当量とを、有機溶媒中で反応させて合成したポリアミド酸が好ましい。

【0093】テトラカルボン酸二無水物成分としては、 3, 3', 4, 4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸 二無水物、メチレン-4,4'-ジフタル酸二無水物、 1, 1-エチリデン-4, 4'-ジフタル酸二無水物、 2, 2-プロピリデン-4, 4'-ジフタル酸二無水 物、1,1,1,3,3-ヘキサフルオロ-2,2 -プロピリデン-4,4'-ジフタル酸二無水物、オキ シー4,4'ージフタル酸二無水物、チオー4,4'ー ジフタル酸二無水物、スルホニル-4,4'ージフタル 酸二無水物、1,3-ビス(3,4-ジカルボキシフェ ニル) -1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサンニ 無水物、9-フェニル-9-(トリフルオロメチル)キ サンテン-2, 3, 6, 7-テトラカルポン酸二無水物 及び9,9-ビス(トリフルオロメチル)キサンテン-2, 3, 6, 7-テトラカルボン酸二無水物から選ばれ る少なくとも1種のジフタル酸二無水物誘導体を0.6 モル当量以上含むものが挙げられる。

【0094】ジアミン化合物としては、オキシー3, 3'ージアニリン、オキシー3,4'ージアニリン、オ キシー4, 4'ージアニリン、スルホニルー3, 3'ー ジアニリン、スルホニルー4,4'ージアニリン、メチ レン-3,3'-ジアニリン、メチレン-4,4'-ジ アニリン、2,2-プロピリデン-3,3'-ジアニリ ン、2,2-プロピリデン-4,4'-ジアニリン、 1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-プ ロピリデン-3,3'-ジアニリン、1,1,1,3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2, 2-プロピリデン-4, 4'-ジアニリン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフ ルオロー2, 2-プロピリデン-5, 5'-ジ(2-ト ルイジン)、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ -2, 2-プロピリデン-4, 4'-ビス(2-アミノ フェノール)から選ばれる少なくとも1種のジアニリン 誘導体を0.6モル当量以上含むものが挙げられる。

【0096】こうしたポリアミド酸は、現像液に対する 溶解速度、露光部と未露光部のコントラスト、基板に対 する密着性などに優れており、特に好ましい。

【0097】前記ポジ型感光性ポリイミドにおける感光性溶解抑止剤としては、例えば、置換もしくは非置換

の、1,2-ナフトキノン-2-ジアジド化合物(1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホン酸エス テル化合物、1,2-ナフトキノン-2-ジアジド-5 - スルホン酸エステル化合物、1,2-ナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホンアミド化合物、1,2-ナ フトキノン-2-ジアジド-5-スルホンアミド化合物 など)、1,2-ナフトキノン-1-ジアジド化合物 (1, 2-ナフトキノン-1-ジアジド-4-スルホン 酸エステル化合物、1,2-ナフトキノン-1-ジアジ ドー5-スルホン酸エステル化合物、1,2-ナフトキ ノン-1-ジアジド-4-スルホンアミド化合物、1, 2-ナフトキノン-1-ジアジド-5-スルホンアミド 化合物など)、キノリン-3,4-キノン-3-ジアジ ド化合物、1,4-ナフトキノン-1-ジアジド化合 物、1,2-ベンゾキノン-1-ジアジド化合物、1, 4-ベンゾキノン-1-ジアジド化合物、ピリジン-3, 4-キノン-3-ジアジド化合物、および1, 4-ジヒドロー4-(2-ニトロフェニル) ピリジン化合物 (ニフェジピンなど) などが挙げられる。

【0098】前記感光性溶解抑止剤としては、フェノール化合物またはアニリン化合物とナフトキノンジアジドスルホニルクロリド化合物を反応させて得られる、ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル化合物またはナフトキノンジアジドスルホン酸アミド化合物を用いることが望ましい。

【0099】ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル化合物の具体例としては、下記(E)群のフェノール化合物と下記(G)群のナフトキノンジアジドスルホニルクロリド化合物とを、水または有機溶媒中で塩基性触媒(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、トリエチルアミンなど)を用いて反応させて、ヒドロキシ基をスルホン酸エステル化した化合物が挙げられる。【0100】また、前記ナフトキノンジアジドスルホニルクロリド化合物とを、水または有機溶媒中で塩をリン化合物と下記(G)群のナフトキノンジアジドスルホニルクロリド化合物とを、水または有機溶媒中で塩リン化合物と下記(G)群のナフトキノンジアジドスルホニルクロリド化合物とを、水または有機溶媒中で塩基性触媒(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、トリエチルアミンなど)を用いて反応させて、アミノ基をスルホン酸アミド化した化合物が挙げられる。【0101】(E)フェノール化合物

置換もしくは非置換の、フェノール、ピロカテコール、レゾルシノール、ハイドロキノン、ベンゼントリオール、ベンゼンテトラオール、ヒドロキシベンジルアルコール、ヒドロキシベンゼンシメタノール、ヒドロキシベンゼントリメタノール、ヒドロキシベンボントリメタノール、オキシジフェノール、チオジフェノール、スルホニルジフェノール、ジヒドロキシベンゾフェノン、トリヒドロキシベンゾフェノン、メチレンジフェノール、エチレンジフェノール、エチリデンジフェノール、プロピリデン

ジフェノール、プチリデンジフェノール、ペンチリデン ジフェノール、メチルプロピリデンジフェノール、メチ ルペンチリデンジフェノール、ヘキサフルオロプロピリ デンジフェノール、フェニルエチリデンジフェノール、 シクロペンチリデンジフェノール、シクロヘキシリデン ジフェノール、フルオレニリデンジフェノール、ジメチ ルシリレンジフェノール、トリス(ヒドロキシフェニ ル)メタン、トリス(ヒドロキシフェニル)エタン、ト リス (ヒドロキシフェニル) プロパン、トリス (4-ヒ ドロキシフェニル) ブタン、フェニルトリス (ヒドロキ シフェニル) メタン、シクロヘキシルトリス (ヒドロキ シフェニル) メタン、ビス(ヒドロキシフェニル) (ジ ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(ヒドロキシフェニ ル) (ジヒドロキシフェニル) エタン、ビス (ヒドロキ シフェニル) { [(ヒドロキシフェニル) プロピル] フ ェニル}メタン、ビス(ヒドロキシフェニル) {[(ヒ ドロキシフェニル) プロピル] フェニル} エタン、ビス (ヒドロキシフェニル) { [(ヒドロキシフェニル)プ ロピル] フェニル} プロパン、ビス(ヒドロキシフェニ ル) { [(ヒドロキシフェニル) プロピル] フェニル} プタン、ビス(ヒドロキシフェニル) { [(ヒドロキシ フェニル) プロピル] フェニル} フェニルメタン、ビス (ヒドロキシフェニル) シクロヘキシル {[(ヒドロキ シフェニル) プロピル] フェニル} メタン、ビス (ヒド ロキシフェノキシ)ベンゼン、ビス(ヒドロキシベンジ ル) ベンゼン、ビス (ヒドロキシフェニルプロピル) ベ ンゼン、ビス (ヒドロキシベンジル) フェノール、ビス (ヒドロキシベンジル) ベンゼンジオール、ビス (ヒド ロキシベンジル) ベンゼントリオール、トリス (ヒドロ キシベンジル) ベンゼンジオール、テトラキス (ヒドロ キシフェニル) エタン、ビス [ビス (ヒドロキシフェニ ル) メチル] ベンゼン、ナフトール、ナフタレンジオー ル、ナフタレントリオール、3,3-ビス(ヒドロキシ フェニル) オキシンドール、3,3-ビス(ヒドロキシ フェニル) フタリドなど。

【0102】 (F) アニリン化合物

置換もしくは非置換の、アニリン、フェニレンジアミン、ベンゼントリアミン、ベンゼンテトラアミン、ヒドロキシアニリン、ベンジジン、オキシジアニリン、チオジアニリン、スルホニルジアニリン、ジアミノベンゾフェノン、メチレンジアニリン、エチレンジアニリン、プロピリデンジアニリン、ブチリデンジアニリン、ペンチリデンジアニリン、メチルペンチリデンジアニリン、ヘキサフルオロプロピリデンジアニリン、フェニルエチリデンジアニリン、シクロペンチリデンジアニリン、シリデンジアニリン、シクロペンチリデンジアニリン、シリアンジアニリン、シクロペンチリデンジアニリン、シスにアミノフェニル)メタン、トリス(アミノフェニル)プロパン、トリス(4-アミノ

フェニル) ブタン、フェニルトリス (アミノフェニル) メタン、シクロヘキシルトリス (アミノフェニル) メタン、ピス (アミノフェノキシ) ベンゼン、トリス (アミノフェニル) メタン、トリス (アミノフェニル) エタン、ナフチルアミン、ナフタレンジアミン、ナフタレントリアミンなど

(G) ナフトキノンジアジドスルホニルクロリド化合物 1, 2 - ナフトキノン - 2 - ジアジド - 4 - スルホニルクロリド、1, 2 - ナフトキノン - 2 - ジアジド - 5 - スルホニルクロリド、1, 2 - ナフトキノン - 1 - ジアジド - 4 - スルホニルクロリド、1, 2 - ナフトキノン - 1 - ジアジド - 5 - スルホニルクロリドなど。

【0103】前記感光性溶解抑止剤としては、下記一般式(2)~(5)で表されるナフトキノンジアジド化合物を用いることが感度及び解像度の面からより望ましい。

[0104]

[化9]

$$(T \xrightarrow{}_{n} \bigcirc (T)_{n} \qquad \dots (5)$$

【0105】(但し、式中、Qはそれぞれ同一でも異なっていても良く、水素基、1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホニル基または1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニル基を示し、式中の少

なくとも1個のQは1, 2- ナフトキノン-2-ジアジド-4-スルホニル基または1, 2- ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニル基である。

【0106】Rはそれぞれ同一でも異なっていても良く、水素基、置換もしくは非置換の、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環基を示す。

【0107】Tはそれぞれ同一でも異なっていても良く、置換もしくは非置換の、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基、複素環基または特性基を示す。

【0108】Xはそれぞれ同一でも異なっていても良く、オキシ基、チオ基、スルホニル基、カルボニル基、メチレン基、エチリデン基、2,2-プロピリデン基、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2,2-プロピリデン基、1-フェニル-1,1-エチリデン基、1,1-シクロヘキシリデン基または9,9-フルオレニリデン基を示す。

【0109】 Z はそれぞれ同一でも異なっていても良く、オキシ基またはイミノ基を示す。

【0110】 jは0~3の整数を示し、kはそれぞれ同一でも異なっていても良く1~3の整数を示し、nはそれぞれ同一でも異なっていても良く0~4の整数を示す。)前記一般式(2)~(5)で表されるナフトキノンジアジド化合物において、式中のRは、それぞれ同一でも異なっていても良く、水素基、置換もしくは非置換の、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環基である。具体的には、水素基、前記(A)群の脂肪族炭化水素基、前記(B)群の脂環式炭化水素基、前記(C)群の芳香族炭化水素基、前記

- (D) 群の複素環基、並びに、脂肪族炭化水素基、脂環 式炭化水素基、芳香族炭化水素基、複素環基を前記
- (a) 群の特性基で置換した、置換脂肪族炭化水素基、置換脂環式炭化水素基、置換芳香族炭化水素基、置換複素環基が挙げられる。特に、水素基、または、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、 sec.-ブチル基、tert.-ブチル基、ペンチル基、tert.-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、フェニル基などの炭素数が6以下の炭化水素基が望ましい。

【0111】前記一般式(2)~(5)で表されるナフトキノンジアジド化合物において、式中のTは、それぞれ同一でも異なっていても良く、置換もしくは非置換の、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基、複素環基または特性基を示す。

【0112】前記一般式(2)~(5)で表されるナフトキノンジアジドスルホン酸エステル化合物またはナフトキノンジアジドスルホン酸アミド化合物において、式中のTは、それぞれ同一でも異なっていても良く、置換

もしくは非置換の、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素 基、芳香族炭化水素基、複素環基または特性基であり、 具体的には、前記(A)群の脂肪族炭化水素基、前記

(B) 群の脂環式炭化水素基、前記(C) 群の芳香族炭化水素基、前記(D) 群の複素環基、前記(a) 群の特性基、並びに、脂肪族炭化水素基、脂環式炭化水素基、芳香族炭化水素基、複素環基を前記(a) 群の特性基で置換した、置換脂肪族炭化水素基、置換複素環基が挙げられる。特に、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec.-ブチル基、tert.-ブチル基、ペンチル基、tert.-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソペキシル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、フェニル基などの炭素数が6以下の炭化水素基が望ましい。

【0113】前記一般式(2)~(5)で表されるナフトキノンジアジド化合物の具体例としては、下記(H)群のフェノール化合物または(I)群のアニリン化合物と、1,2ーナフトキノン-2ージアジド-4ースルホニルクロリドまたは1,2ーナフトキノン-2ージアジド-5-スルホニルクロリドとを、水または有機溶媒中で塩基性触媒を使用し、ヒドロキシ基またはアミノ基をスルホン酸エステル化またはスルホン酸アミド化した化合物が挙げられる。ここで用いられる塩基性触媒としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウム、トリエチルアミンなどが挙げられる。

【0114】なお、溶解抑止効果の観点から、式中のQ基へのナフトキノンジアジドスルホニル基の平均導入率は40モル%以上が望ましい。

【0115】(H)フェノール化合物

トリス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、1,1,1 ートリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1,1, 1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、1、 1, 1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)プタン、フ ェニルトリス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、シク ロヘキシルトリス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、 トリス (4-ヒドロキシ-2-メチルフェニル) メタ ン、1、1、1-トリス(4-ヒドロキシー2-メチル フェニル) エタン、トリス (4-ヒドロキシー3-メチ ルフェニル) メタン、1, 1, 1-トリス(4-ヒドロ キシー3-メチルフェニル) エタン、ビス(4-ヒドロ キシフェニル) (2-ヒドロキシフェニル) メタン、ビ ス(4-ヒドロキシフェニル) (3-ヒドロキシフェニ ル) メタン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)(3, 4 ージヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキ シー2-メチルフェニル) (2-ヒドロキシフェニル) メタン、ピス(4-ヒドロキシ-2-メチルフェニル) (3-ヒドロキシフェニル) メタン、ピス (4-ヒドロ キシー2-メチルフェニル) (4-ヒドロキシフェニ ル) メタン、ビス(4-ヒドロキシ-2-メチルフェニ

ル) (3, 4-ジヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル) (2-ヒドロ キシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシー3-メ チルフェニル) (3-ヒドロキシフェニル) メタン、ビ ス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)(4-ヒド ロキシフェニル)メタン、ビス(4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) (3,4-ジヒドロキシフェニル)メ タン、ビス(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニ ル) (2-ヒドロキシフェニル) メタン、ピス (4-ヒ ドロキシー3, 5ージメチルフェニル) (3ーヒドロキ シフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニル) (4-ヒドロキシフェニル) メタ ン、ビス(4-ヒドロキシー3,5-ジメチルフェニ ル) (3, 4-ジヒドロキシフェニル) メタン、ピス (4-ヒドロキシ-3-イソプロピルフェニル) (2-ヒドロキシフェニル)メタン、ビス(4-ヒドロキシー 3-イソプロピルフェニル) (3-ヒドロキシフェニ ル) メタン、ビス(4-ヒドロキシ-3-イソプロピル フェニル) (4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシ-3-イソプロピルフェニル) (3, 4-ジヒドロキシフェニル) メタン、ピス(4-ヒドロ キシ-3-t-ブチルフェニル) (2-ヒドロキシフェ ニル) メタン、ピス(4-ヒドロキシ-3-t-ブチル チルフェニル) (3-ヒドロキシフェニル) メタン、ビ ス(4-ヒドロキシ-3-t-ブチルフェニル)(4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシー 3-t-ブチルフェニル) (3, 4-ジヒドロキシフェ ニル) メタン、ビス(4-ヒドロキシ-3-シクロヘキ シルフェニル) (2-ヒドロキシフェニル) メタン、ビ ス(4-ヒドロキシ-3-シクロヘキシルフェニル) (3-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロ キシー3-シクロヘキシルフェニル) (4-ヒドロキシ フェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシー3-シクロ ヘキシルフェニル) (3,4-ジヒドロキシフェニル) メタン、ビス(4-ヒドロキシ-5-シクロヘキシルー 2-メチルフェニル) (2-ヒドロキシフェニル) メタ ン、ビス(4ーヒドロキシー5ーシクロヘキシルー2ー メチルフェニル) (3-ヒドロキシフェニル) メタン、 ピス (4-ヒドロキシ-5-シクロヘキシル-2-メチ ルフェニル) (4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシ-5-シクロヘキシル-2-メチルフ ェニル) (3, 4-ジヒドロキシフェニル) メタン、ビ ス(4-ヒドロキシ-2,3,5-トリメチルフェニ ル) (2-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒ ドロキシー2, 3, 5-トリメチルフェニル) (3-ヒ ドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシー 2, 3, 5-トリメチルフェニル) (4-ヒドロキシフ ェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシ-2, 3, 5-トリメチルフェニル) (3, 4-ジヒドロキシフェニ

ル) メタン、ピス(4-ヒドロキシフェニル) {4-

[2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-プロピル]フ ェニル} メタン、1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニ ル) -1- {4- [2- (4-ヒドロキシフェニル) -2-プロピル] フェニル} エタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル) -1- {4-[2-(4-ヒドロ キシフェニル) -2-プロピル] フェニル} プロパン、 1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-{4-[2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-プロピル]フ ェニル}プタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) -1- {4- [2-(4-ヒドロキシフェニル) -2 -プロピル] フェニル $\} - 1 -$ フェニルメタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-シクロヘキ シルー1-{4-[2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-プロピル]フェニル]メタン、オキシー4,4'-ジフェノール、チオジー4,4'-フェノール、スルホ ニルー4,4'ージフェノール、メチレンー4,4'ー ジフェノール、1,1-エチリデン-4,4'ージフェ ノール、2,2-プロピリデン-4,4'-ジフェノー ル、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2 ープロピリデンー4,4'ージフェノール、1ーフェニ ルー1, 1ーエチリデンー4, 4'ージフェノール、 2, 2-プロピリデン-4, 4'-ビス(2-メチルフ ェノール)、2,2-プロピリデン-4,4'-ビス (3-メチルフェノール)、2,2-プロピリデンー 4, 4'-ビス(3, 5-ジメチルフェノール)、2, 2-プロピリデン-4,4'-ピス(3-イソピロピル フェノール)、2,2-プロピリデン-4,4'-ビス (3-t-プチルフェノール)、2,2-プロピリデン -4,4'-ビス(3-シクロヘキシルフェノール)、 2, 2-プロピリデン-4, 4'-ビス(3-フェニル フェノール)、シクロヘキシリデンー4、4'ージフェ ノール、シクロヘキシリデンー4,4'ーピス(2-メ チルフェノール)、シクロヘキシリデン-4,4'-ビ ス(3-メチルフェノール)、シクロヘキシリデンー 4, 4'-ピス(3, 5-ジメチルフェノール)、シク ロヘキシリデン-4,4'-ビス(3-イソピロピルフ ェノール)、シクロヘキシリデン-4,4'-ビス(3 -t-ブチルフェノール)、シクロヘキシリデンー4, 4'-ビス(3-シクロヘキシルフェノール)、シクロ ヘキシリデンー4, 4'ーピス(3-フェニルフェノー ル)、9,9-フルオレニリデン-4,4'-ジフェノ ール、4,4'-ジヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2, 4, 4' ートリヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン、3,3-ビス(4-ヒドロキシフェニル) フタリド、3,3-ビス(4-ヒ ドロキシー2-メチルフェニル) フタリド、3,3-ビ ス (4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) フタリドな ٤.

【0116】(I)アニリン化合物

【0117】ナフトキノンジアジド化合物としては、溶解抑止性や光透明性の観点から、次のようなフェノール化合物またはアニリン化合物と、1,2ーナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロリド化合物とを反応させた、平均導入率50モル%以上の1,2ーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル化合物または1,2ーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸アミド化合物が特に望ましい。なお、平均導入率とは、式中のQ中の1,2ーナフトキノンジアジド-5-スルホニル基の導入率を表す。

【0118】フェノール化合物としては、トリス(4-ヒドロキシフェニル)メタン、1、1、1-トリス(4 -ヒドロキシフェニル) エタン、ビス(4-ヒドロキシ フェニル) (3, 4-ジヒドロキシフェニル) メタン、 ピス (4-ヒドロキシ-5-シクロヘキシル-2-メチ ルフェニル) (2-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒドロキシ-5-シクロヘキシル-2-メチルフ ェニル) (3-ヒドロキシフェニル) メタン、ピス (4 -ヒドロキシ-5-シクロヘキシル-2-メチルフェニ ル) (4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (4-ヒ ドロキシ-5-シクロヘキシル-2-メチルフェニル) (3, 4-ジヒドロキシフェニル) メタン、ビス(4-ヒドロキシフェニル) {4-[2-(4-ヒドロキシフ ェニル) -2-プロピル] フェニル} メタン、1,1-ビス (4-ヒドロキシフェニル) -1- {4-[2-(4-ヒドロキシフェニル) -2-プロピル] フェニ ル} エタン、2, 2-プロピリデン-4, 4'ージフェ ノール、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー 2, 2'-プロピリデン-4, 4'-ジフェノール、 3, 3-ピス(4-ヒドロキシフェニル)フタリド、 3, 3-ビス(4-ヒドロキシ-2-メチルフェニル) フタリド、3,3ーピス(4ーヒドロキシー3ーメチル フェニル) フタリドなどが挙げられる。

【0119】アニリン化合物としては、オキシ-3,3 -ジアニリン、オキシ-3,4-ジアニリン、オキシ- 【0120】前記ポジ型感光性ポリイミドの溶液におい ては、感度を増加させるために必要に応じて増感剤を使 用しても良い。増感剤としては、具体的には、アセトフ ェノン、ペンゾフェノン、ペンゾイン、2-メチルベン ゾイン、ペンゾインイソプロピルエーテル、アントロ ン、1,9-ベンゾアントロン、アントラセン、フェナ ンスレンキノン、ピレン-1,6-キノン、9-フルオ レノン、1,2-ベンゾアントラキノン、アントアント ロン、2-クロロベンズアントラキノン、2-プロモベ ンズアントラキノン、2-クロロ-1,8-フタロイル ナフタレン、ミヒラーケトン、4,4'-ビス(ジエチ ルアミノ) ベンゾフェノン、ベンゾインメチルエーテ ル、ベンジルジメチルケタール、2-メチル-1-[4 - (メチルチオ)フェニル]-2-モルホリノー1-プ ロパノン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケト ン、N、N-ジメチルアミノ安息香酸エチル、アクリジ ン、シアノアクリジン、ニトロピレン、1,8-ジニト ロピレン、5-ニトロアセナフテン、2-ニトロフルオ レン、2-ターシャリープチル-9,10-アントラキ ノン、N-フェニルマレイミドなどが挙げられる。

【0122】また、前記のポジ型感光性ポリイミドの溶液においては、必要に応じて染料、界面活性剤、アルカリ可溶性樹脂などを配合しても良い。

【0123】前記のポジ型感光性ポリイミドの溶液の調製に当たっては、まず、ポリイミド前駆体の溶液に、感光性溶解抑止剤を添加し溶解し、必要に応じて適当な有機溶媒で希釈する。さらに、必要に応じて増感剤、染料、界面活性剤、アルカリ可溶性樹脂などを添加・溶解する。その後、所望により濾過などの方法で微細な不純物を除去して調製することができる。感光性溶解抑止剤は、ポリイミド前駆体に対して1~50wt%添加することが望ましく、10~40wt%添加することがより好ましい

【0124】この際、使用される有機溶剤としては、例

えば、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチ ルアセトアミド、N, N-ジエチルアセトアミド、N, N-ジメトキシアセトアミド、N-メチル-2-ピロリ ドン、N-アセチル-2-ピロリドン、N-ベンジル-2-ピロリドン、1、3-ジメチル-2-イミダゾリジ ノン、ヘキサメチルホスホルトリアミド、N-メチルー ε - π -ム、1,2-ジメトキシエタン、1,2-ジエトキシエ タン、ピス(2-メトキシエチル)エーテル、ピス(2 ーエトキシエチル) エーテル、1,2-ビス(2-メト キシエトキシ) エタン、ビス [2-(2-メトキシエト キシ) エチル] エーテル、1-アセトキシ-2-メトキ シエタン、1-アセトキシ-2-エトキシエタン、(2 -アセトキシエチル) (2-メトキシエチル) エーテ ル、(2-アセトキシエチル)(2-エトキシエチル) エーテル、3-メトキシプロピオン酸メチル、テトラヒ ドロフラン、1, 3-ジオキサン、1, 3-ジオキソラ ン、1,4-ジオキサン、ピロリン、ピリジン、ピコリ ン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、ィープチロラ クトン、炭酸プロピレン、フェノール、クレゾール、ア セトン、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケト ン、シクロヘキサノン、アセトニルアセトンなどが例示 され、これらの有機溶剤は単独で用いてもよいし、2種 以上混合して用いてよい。

【0125】ポジ型感光性ポリイミドの溶液としては、次のように調製されたものが好ましい。まず、前記一般式(1)で表されるポリアミド酸の溶液に、前記一般式(2)~(5)で表されるナフトキノンジアジド化合物を添加して、メカニカルスターラー、マグネチックスターラー、レシプロシェーカー、ミックスローターなどにより混合攪拌する。この際、必要に応じて適当な有機溶媒で希釈してもよい。ナフトキノンジアジド化合物の添加量は、ポリイミド前駆体に対して1~50wt%である。さらに、必要に応じて増感剤、染料、界面活性剤、アルカリ可溶性樹脂などを添加・溶解し、所望により濾過などの方法で微細な不純物を除去して、ポジ型感光性ポリイミドの溶液を調製する。

【0126】前記(II)の工程は、前記樹脂層を所望のパターンを有するフォトマスクを介して、樹脂層に、可視光、赤外光、紫外光、EB、X線などのエネルギー線を照射し、前記樹脂層の所望領域を露光することにより行われる。この時の露光方法としては、密着露光、投影露光の何れの方式でも良い。

【0127】尚、前記露光工程中または前記露光工程後に、必要に応じて、解像特性を改善する目的でホットプレートなどによるPEB(露光後ベーク)を行っても良い。PEBを行う場合の加熱温度としては、通常80~160℃程度が望ましく、加熱時間は通常10sec~10min程度で十分である。

【0128】前記 (III) の工程は、前記露光工程後

(または必要に応じて前記PEB工程後) 本発明の感光性ポリイミド用現像液を用いて、樹脂層を現像する現像工程である。現像により、樹脂層の露光部が溶解除去され、所望のポジ型のパターンが形成される。また、現像は、浸漬法、スプレー現像法、パドル現像法などにより行われる。

【0129】尚、現像工程後において、現像液残渣などを除去する目的で、水、アルコール、水-アルコール混合溶液などを用いてリンス処理することが望ましい。

【0130】前記(IV)の工程は、前記現像工程後、現像液やリンス液を乾燥するため、ポリイミド前駆体を加熱イミド化してイミド膜とするため及び添加した感光性溶解抑止剤などを熱分解除去するために、パターン形成された樹脂層にホットプレートやオーブンにより120~450℃の熱処理を施す工程である。尚、この工程で300℃以上の高温で熱処理を施す場合には、ポリイミド膜の熱酸化などを防ぐために、真空中または窒素ガスやアルゴンガスなどの不活性ガス気流下で行うことが望ましい。

【0131】本発明の電子部品は、上記ポリイミド膜パターン形成方法により得られるポリイミド膜を少なくとも絶縁部材、保護膜部材、液晶素子部材または光学素子部材として具備することを特徴とするものである。電子部品としては、例えば、層間絶縁保護層が導電体または半導体間にポリイミドなどのポリマー樹脂で形成された多層配線層を有するLSI素子、導電体または半導体間の耐湿絶縁保護層としてポリイミドなどのポリマー樹脂のパッシベーション膜を用いた半導体素子、導電体または半導体間の絶縁保護層にポリイミドなどのポリマー樹脂を用いた電子部品、絶縁保護層がシリコンウェハーー配線間あるいは配線ー配線間にポリイミドなどのポリマ

ー樹脂で形成された電子部品、絶縁保護層が基板材料ー配線間あるいは配線ー配線間にポリイミドなどのポリマー樹脂で形成された薄膜磁気ヘッド、絶縁保護層が基板材料ー配線間あるいは配線ー配線間にポリイミドなどのポリマー樹脂で形成された高密度プリント配線基板、絶縁保護層が基板材料ー配線間あるいは配線ー配線間にポリイミドなどのポリマー樹脂で形成された磁気バブルメモリー、絶縁保護層が基板材料ー配線間あるいは配線ー配線間にポリイミドなどのポリマー樹脂で形成された太陽電池、光導波路としてポリイミドなどのポリマー樹脂を用いた光学素子などが挙げられる。

【0132】以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細 に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるも のではない。

【0133】(1)ポリアミド酸の合成

下記表1に示す原料を所定の配合比(モル当量で表示)で用い、以下のようにしてポリアミド酸を合成した。まず、アルゴンガス雰囲気下、冷媒により-5℃~5℃に冷却したセパラブルフラスコにN, N-ジメチルアセトアミド50mLを収容しテトラカルボン酸二無水物を加えて攪拌しながら分散した。この分散液に、ジアミン化合物の所定量をN, N-ジメチルアセトアミド50mLに溶解した溶液を、圧力平衡管付き滴下漏斗によりゆっくりと滴下し、4時間攪拌した。さらに、室温で4時間攪拌して、目的のポリアミド酸を得た。

【0134】合成されたそれぞれのポリアミド酸の0.5wt%N,N-ジメチルアセトアミド溶液のインヒーレント粘度を<math>30%において測定した。これらの結果を表1に示す。

【0135】 【表1】

表 1

				24 1				
	PAA1	PAA2	PAA3	PAA4	PAA5	PAA6	PAA7	PAA8
BNTA	1.00	-	-	1. 00	-	-	-	-
ODPA	-	1.00	-	-	~	1.00	_	-
6FPA	-	-	1.00	_	1.00	-	1.00	-
PMA	_	-	-	-	-	_	-	1.00
O D A	0. 95	0. 95	0.95	_	-	-	0. 75	0.95
SNDA	-	_	-	0. 95	0.95	-	_ "	_
6FDA	-	-	-	_	_	0. 95	0. 20	_
TSDA	0. 05	0. 05	0.05	0. 05	0.05	0. 05	0. 05	0.05
溶媒	DMAC	DMAC	DMAC	DMAC	DMAC	DMAC	DMAC	DMAC
濃度 wt%	20. 18	20. 42	20.35	19. 55	20.63	19. 24	20. 65	18, 20
インセーレント 粘度*) [dL/g]	0, 98	0, 82	0. 68	0, 92	0. 60	0. 94	0. 66	1. 10

*) 0.5 wt%DMAC 溶液、 測定温度:30℃

【0136】ここで、表1に表記したテトラカルボン酸二無水物、ジアミン化合物および溶媒の略号は、以下の化合物を示す。

【0137】 (テトラカルボン酸二無水物) BNTA: 3, 3', 4, 4'ーペンプフェノンテトラ カルボン酸二無水物 ODPA:オキシー4, 4'ージフタル酸二無水物

6 F P A: 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2,2-プロピリ

デン-4.4'-ジフタル酸二無水物 PMA:ピロメリト酸二無水物

(ジアミン化合物)

ODA:オキシー4,4'ージアニリン

SNDA:スルホニル-3, 3'-ジアニリン

6 FDA: 1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2,2-プロピリ

デン-4,4'-ジアニリン

TSDA:1,3-ピス(3-アミノプロピル)-1,1,3,3-テト

ラメチルジシロキサン(溶媒)

DMAC: N. N-ジメチルアセトアミド

(2) ポジ型感光性ポリイミドの溶液の調製

表 1 に示した合成したポリアミド酸溶液に、表 2 に示した感光性溶解抑止剤を所定の配合比(ポリアミド酸に対する重量%で表示)で加え、室温においてミックスローターで均一になるまで攪拌混合した。これを細孔 0. 2 μ mのメンプランフィルターで濾過することにより、目的のポジ型感光性ポリイミドの溶液を調製した。

[0138]

【表2】

表	2

			24					
感光性	ポリアミド	感光性	添加量*)		感光性	ポリアミド	感光性	添加量*)
ポリイミド	酸の溶液	溶解抑止剤	(wt%)	L	ポリイミド	酸の溶液	溶解抑止剤	(wt%)
PPI1	PAA1	PS-1	20. 0		PPIII	PAA4	PS-2	20. 0
PPI2	PAA2	PS-1	20. 0		PP112	PAA7	PS-2	20. 0
PPI3	PAA3	PS-1	20. 0		PP I 13	PAA3	PS-3	20.0
PP14	PAA4	PS-1	20. 0		PPI 14	PAA4	PS-3	20.0
PP15	PAA5	PS-1	20. 0		PP I 15	PAA7	PS-3	20.0
PPI6	PAA6	PS-1	20. 0		PP116	PAA3	PS-4	20.0
PP 17	PAA7	PS-1	20. 0		PPI17	PAA4	PS-4	20.0
PP18	PAA1	PS-2	20. 0		PPI18	PAA7	PS-4	20.0
PPI9	PAA2	PS-2	20. 0		PPI 19	PAA3	PS-5	20.0
PPI10	PAA3	PS-2	20. 0		PPI20	PAA7	PS-5	20.0

*) ポリアミド酸に対する重量%

【0139】ここで、表2に表記した感光性溶解抑止剤の略号は、以下の化合物を示す。

【0140】 PS-1: トリス(4-ヒドロフェニル)メタンとNAC5(1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニルクロリド)の反応化合物(フェノール性OH基に対するナフトキノンジアジドスルホニル基の平均導入率: 70モル%)

PS-2:1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)- 1- $\{4$ -[2-(4-ヒドロキシフェニル)-2-プロピル]フェニル $\}$ エタンとNAC5との反応化合物(フェノール性OH基に対するナフトキノンジアジドスルホニル基の平均導入率:70モル%)

PS-4:3, 3-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フ

タリドとNAC5との反応化合物(フェノール性OH基に対するナフトキノンジアジドスルホニル基の平均導入率:100モル%)

PS-5:オキシー4, 4'-ジアニリンとNAC5との反応化合物 (NH2基に対するナフトキノンジアジドスルホニル基の平均導入率:100モル%)

(3) 現像液の調製

表3および表4に示す塩基性化合物を、所定の濃度(重量濃度及びモル濃度で表示)になるようにイオン交換水で溶解・希釈し、これを細孔 0.2μ mのメンプランフィルターで濾過することにより、目的の現像液の水溶液を調製した(DEV-1~15)。また、比較のために、本発明外の塩基性化合物 [弱塩基性アミン(WAM-1~3)、強塩基性アミン(SAM-1~9)、無機アルカリ塩(ALK-1~3)]も同様の方法で調製した。

[0141]

【表3】

表 3

現像液	塩基性化合物	塩基解離指数 pKb*)	重量濃度 (wt%)	モル濃度 (mol/L)	pH (20℃)
DEV-1	N-メチルイミダソール	6. 87	1.64	0.200	10.39
DEV-2	N-メチルモルホリン	6. 59	2. 02	0. 200	10. 49
DEV-3	5-メチル-3, 4-ジヒドロ-2H-ピロール [2-メチル-1-ピロリン]	6. 09	1.66	0. 200	10. 77
DEV-4	2-(ジメチルアミノ)プロピオニトリル	6. 35	1.96	0. 200	10. 59
DEV-5	トリエタノールアミン	6. 24	2. 98	0. 200	10.72
DEY-6	N-メチルジエタノールアミン	5. 48	2. 38	0. 200	11. 11
DEV-7	N-エチルイミダソール	6, 67	1.92	0. 200	10.42
DEV-8	ドメチルイミダソール	6. 87	2.00	0. 211	10. 43
DEV-9	N-メチルモルホリン	6. 59	2. 00	0.198	10. 48
DEV-10	トリエタノールアミン	6. 24	2.00	0.134	10.61
DEV-11	N-メチルジエタノールアミン	5. 48	2.00	0. 168	11.06
DEV-12	N-メチルイミダゾール	6. 87	3. 00	0.366	10.46
DEY-13	N-メチルモルホリン	6. 59	3. 00	0. 297	10. 52
DEV-14	トリエタノールアミン	6. 24	3. 00	0. 201	10.72
DEY-15	N-メチルジエタノールアミン	5. 48	3.00	0. 252	11. 16

*) 25℃の水溶液の値[pKb = l4 - pKa (プロトン錯体の酸解離指数)]

[0142]

【表4】

現像液	塩基性化合物	塩基解離指 数 p Kb*)	重量濃度 (wt%)	モル濃度 (mol/l.)	pH (20°C)
WAM-1	N, N-ジメチルアニリン	8. 88	2. 42	0. 200	9. 25
WAM-2	ピリジン	8. 83	1.58	0. 200	9. 30
WAM-3	N-メチルベンゾイミダゾール	8. 43	2. 64	0. 200	9. 50
SAM-1	2-アミノエタノール	4. 50	1.22	0. 200	11. 67
SAM-2	2-(ジエチルアミノ) エタノール	3. 90	2. 34	0. 200	11.82
SAM-3	トリエチルアミン	3. 29	2. 02	0, 200	12. 29
SAM-4	ピペリジン	2, 87	1.70	0. 200	12. 43
SAM-5	テトラメチルアンモニウムヒドロキシド	<0	1.82	0. 200	13. 45
SAM-6	テトラメチルアンモニウムヒドロキシド	<0	0.40	0.044	12. 89
SAM-7	テトラメチルアンモニウムヒドロキシド	<0	0. 20	0. 022	12. 60
SAM-8	2-アミノエタノール	4.50	0.50	0.082	11.36
SAM-9	2-(ジエルアミノ) エタノール	3.90	0. 70	0.060	11.63
ALK-1	炭酸カリウム	3. 69	1. 38	0. 100	11.80
ALK-2	水酸化ナトリウム	<0	0.80	0. 200	13. 41
ALK-3	水酸化ナトリウム	<0	0. 20	0.050	12. 92

*) 25℃の水溶液の値[pKb = 14 - pKa (プロトン錯体の酸解離指数)]

【0143】(4)残膜特性評価

感光性ポリイミドの溶液 (PPI1) をスピンコート法 により4インチ径のシリコンウェハー上に塗布し、10 0℃のホットプレート上で3分間加熱(プリベーク)し て、膜厚約5μmの樹脂層を形成した。初期膜厚を、タ ーリーステップ (Taylor-Hobson Mod e 1) により測定した。次に、露光装置(キャノン社 製:PLA-501FA)により、残膜特性評価用石英 マスクを介して前記樹脂層の表面に露光を施した。

【0144】この後、前記シリコンウェハーを表5およ

び表6に示した現像液中に30秒間(または60秒間) 浸漬し、更に20秒間水洗した。最後に、窒素エアガン で樹脂層を乾燥し、ポリイミド前駆体パターン膜を作製 した(実施例1~7及び比較例1~15)。

【0145】こうして形成されたパターン膜の断面をカ ミソリで切断・剥離し、ターリーステップにより露光部 及び未露光部の膜厚を測定し、初期膜厚と比較すること により、残膜特性を検討した。この結果を表5および表 6に示す。

[0146]

【表5】

	_
-223	_
AY	

	感光性 ポリイ ミド	膜厚 (μm)	高照射量 (mJ/cm ²)	現像液	現像時間 (sec)	露光部殘膜率(%)	未露光部残膜率 (%)
実施例1	PPIt	5. 0	300	DEV-1	30	0	96
実施例2	PPII	5.0	300	DEV-2	30	0	95
実施例3	PPII	5.0	300	DEV-3	30	0	95
実施例 4	PPII	5.0	300	DEV-4	30	0	95
実施例 5	PP I 1	5. 0	300	DEV-5	30	0	88
実施例 6	PPII	5. 0	300	DEV-6	30	0	82
実施例7	PPI1	5. 0	300	DEV-7	30	0	96
比較例1	PPI1	5.0	300	WAM-1	30	100	100
比較例2	PP11	5. 0	300	WAM-2	30	100	100
比較例3	PPII	Б. О	300	WAM-3	30	100	100
比較例4	PPI1	5. 0	300	SAM-1	30	0	38
比較例 5	PPII	5, 0	300	SAM-2	30	0	12
比較例6	PPI1	5. 0	300	SAM-3	30	0	0
比較例7	PPI1	5.0	300	SAM-4	30	0	0
比較例8	PPI1	5. 0	300	SAM-5	30	0	0
比較例9	PPIt	5. 0	300	SAM-6	60	0	42
比較例 10	PPII	5. 0	300	SAM-7	60	5	55

[0147]

【表6】

6

				<u> </u>			
	感光性 ポリイミド	膜厚 (μm)	高照射量 (mJ/cm ²)	現像液	現像時間 (sec)	露光部残膜率(%)	未露光部 残膜率 (%)
比較例 11	PPli	5. 0	300	SAM-8	60	0	56
比較例 12	PPI1	5.0	300	SAM-9	60	0	48
比較例 13	PPI1	5.0	300	ALK-1	30	0	0
比較例 14	PPII	5, 0	300	ALK-2	30	0	0
比較例 15	PPII	5. 0	300	ALK-3	60	0	40

【0148】同濃度(0.2mo1/L)の現像液で比 較すると、次のことがわかる。すなわち、本発明の現像 液を用いた場合には、露光部残膜0で、未露光部残膜が 82~96%と良好な残膜特性を示す (実施例1~7) のに対し、本発明のアミン化合物より弱塩基性(pKb >8)のアミン化合物を使用した現像液では露光部及び 未露光部とも溶解せずパターン形成できない(比較例1 ~3)。また、本発明のアミン化合物より強塩基性 (p Kb<5)のアミン化合物および無機アルカリ塩を使用 した現像液では、未露光部の残膜率が0~38%と残膜 特性が非常に悪い(比較例4~8、13、14)。さら に、本発明のアミン化合物より強塩基性 (pKb<5) のアミン化合物及び無機アルカリ塩を使用した現像液を 10倍程度希釈した場合には、現像時間を長くする(6 0 s e c) とパターンを形成することができる。しかし ながら、残膜特性は40~56%と依然として悪い(比 較例9、11、12、15)。

【0149】この結果から、本発明の現像液を使用することにより、感光性溶解抑止剤添加タイプのポジ型感光性ポリイミドの残膜特性を大幅に改善することができ、高残膜でパターン形成できることが示唆される。

【0150】(5)解像特性評価

表7ないし表13に示す感光性ポリイミドの溶液をスピンコート法により4インチ径のシリコンウェハー上に塗布し、100℃のホットプレート上で3分間加熱(プリベーク)して、膜厚約5 μ mの樹脂層を形成した(ターリーステップにより初期膜厚を測定)。次に、露光装置(キャノン社製:PLA-501FA)により、解像特性評価用石英マスクを介して前記樹脂層の表面に露光を施した。

【0151】この後、前記シリコンウェハーを表7ないし表13に示した現像液中に $40\sim120$ 秒間浸漬し、更に20秒間水洗した。最後に窒素エアガンで樹脂層を乾燥し、ポリイミド前駆体パターン膜を作製した(実施

例8~66及び比較例16~69)。

性試験の結果を表7ないし表13に示す。

[0153]

【表7】

【0152】ターリーステップにより露光部及び未露光 部の膜厚を測定した。さらに、形成されたパターン膜の

	感光性	膜厚(μm)	感度	現像液	現像時間	解像特性	未露光部
	ポリイミド	ж. (д)	(mJ/cm ²)	20412	(sec)	(μm)	残膜率(%)
実施例8	PPII	5. 0	180	DEV-8	60	5.0	96
実施例9	PP I 1	5. 0	180	DEV-9	60	5. 5	95
実施例 10	PPI1	5. 0	180	DEV-10	60	7. 0	88
実施例 11	1199	5. 0	180	DEV-11	60	8.0	82
実施例 12	PP12	5. 0	160	DEV-8	60	5.0	95
実施例 13	PP12	5. 0	160	DEV-9	60	5. 5	95
実施例 14	PP12	5.0	160	DEV-10	60	7. 0	86
実施例 15	PP12	5. 0	160	DEV-11	60	8. 0	80
実施例 16	PP13	4.8	140	DEV-12	40	4. 0	96
実施例 17	PP13	4.8	140	DEV-13	40	4. 5	96
実施例 18	PPI3	4.8	140	DEV-14	40	5, 0	89
実施例 19	PPI3	4.8	140	DEV-15	40	6. 0	83
実施例 20	PPI4	5, 1	160	DEV-8	60	4. 5	95
実施例 21	PP14	5. 1	160	DEV-9	60	5. 0	95
実施例 22	PPI4	5. 1	160	DEV-10	60	6. 0	85
実施例 23	PPI4	5. 1	160	DEV-11	60	8. 0	80
実施例 24	PPI5	4.8	140	DEV-12	40	4. 0	97
実施例 25	PP15	4.8	140	DEV-13	40	4. 5	95

[0154]

【表8】

			30X C)	_		
	感光性 ポリイミド	膜厚(μm)	感度 (mJ/cm ²)	現像液	現像時間 (sec)	解像特性 (μm)	未露光部 残膜率(%)
実施例 26	PP15	4, 8	140	DEV-14	40	5.0	88
実施例 27	PP15	4.8	140	DEV-15	40	6.0	81
実施例 28	PP16	5. 2	160	DEV-12	40	5.0	96
実施例 29	PP16	5. 2	160	DEV-13	40	5.5	96
実施例 30	PP16	5. 2	160	DEV-14	40	7.0	89
実施例 31	PP16	5. 2	160	DEV-15	40	8. 0	83
実施例 32	PP17	4.9	140	DEV-12	60	4. 0	95
実施例 33	PP17	4. 9	140	DEV-13	60	4. 5	95
実施例 34	PP17	4. 9	140	DEV-14	60	5. 0	88
実施例 35	PP17	4. 9	140	DEV-15	60	6. 0	82
実施例 36	PP18	5. 0	180	DEV-8	60	5. 0	96
実施例 37	PP18	5. 0	180	DEV-9	60	5. 5	95
実施例 38	PP18	5. 0	180	DEV-10	60	7. 0	88

[0155]

【表9】

	感光性ポ リイミド	膜厚(μm)	感度 (mJ/cm ²)	現像被	現像時間 (sec)	解像特性 (µm)	未露光 部残膜 率(%)
実施例 39	PP19	5. 0	160	DEV-8	60	5. 0	95
実施例 40	PP19	5. 0	160	DEV-9	60	5.5	95
実施例 41	PPI9	5. 0	160	DEV-10	60	7.0	87
実施例 42	PP110	4.8	140	DEV-12	40	4.0	95
実施例 43	PPI10	4.8	140	DEV-13	40	4.5	95
実施例 44	PPI10	4.8	140	DEV-14	40	5.0	85
実施例 45	PPIIL	5. 1	160	DEV-8	60	4.5	96
実施例 46	PPI11	5. 1	160	DEV-9	60	5.0	95
実施例 47	PPI11	5 . 1	160	DEV-10	60	6.0	88
実施例 48	PPI12	4.9	140	DEV-12	40	4. 0	95
実施例 49	PPI12	4. 9	140	DEV-13	40	4. 5	95
実施例 50	PPI12	4. 9	140	DEV-14	40	5. 0	86
実施例 51	PPI13	4.8	140	DEV-12	40	4. 5	94
実施例 52	PPI 13	4.8	140	DEV-13	40	5. 0	94
実施例 53	PPI 14	5. 1	160	DEV-8	60	5. 0	92
実施例 54	PPI 14	5. 1	160	DEV-9	60	6, 0	92
実施例 55	PPI 15	4. 9	140	DEV-12	60	4. 5	95

[0156]

【表10】 表 10							
	感光性ポ リイミド	膜厚 (μm)	感度 (mJ/cm ²)	現像液	現像時間 (sec)	解像特性 (µm)	未露光 部残膜 率(%)
実施例 56	PPJ15	4.9	140	DEV-13	60	ნ. 0	94
実施例 57	PPI16	4.8	140	DEV-12	40	4. 5	95
実施例 58	PP116	4.8	140	DEV-13	40	5. 0	94
実施例 59	PPI 17	5. 1	160	DEV-8	60	5. 0	92
実施例 60	PPI17	5. 1	160	DEV-9	60	6. 0	91
実施例 61	PP118	4. 9	140	DEV-12	60	4. 5	94
実施例 62	PPI 18	4.9	140	DEV-13	60	5. 0	94
実施例 63	PPI19	4.8	140	DEV-12	40	4. 0	95
実施例 64	PP119	4.8	140	DEV-13	40	4. 5	95
実施例 65	PPI20	4.9	140	DEV-12	60	4. 0	96
実施例 66	PPI20	4. 9	140	DEV-13	60	4. 5	95
比較例 16	PPII	5. 0	180	SAM-6	60	>30	42
比較例 17	PPI1	5. 0	180	SAM-8	60	25	56
比較例 18	PPI1	5. 0	180	SAM-9	60	>30	48
比較例 19	PPI1	5. 0	180	ALK-3	60	>30	40
比較例 20	PPI2	5. 0	160	SAM-6	60	>30	35
比較例 21	PPI2	5. 0	160	SAM-8	60	30	52

[0157]

表 11

	感光性	模厚	感度			解像特性	未露光部
	ポリイミド	(μm)	(mJ/cm ²)	現像液	現像時間(sec)	(μm)	戏膜率(X)
比較例 22	PP12	5.0	160	SAM-9	60	>30	42
比較例 23	PPI2	5.0	160	ALK-3	60	>30	36
比較例 24	PPI3	4.8	140	SAM-6	80	25	56
比較例 25	PPI3	4.8	140	SAM-8	80	20	66
比較例 26	PP I 3	4.8	140	SAM-9	80	20	60
比較例 27	PPI3	4.8	140	ALK-3	80	30	52
比較例 28	PPI4	5. 1	160	SAM-6	60	>30	44
比較例 29	PPI4	5. 1	160	SAM-8	60	30	54
比較例 30	PPI4	5. 1	160	SAM-9	60	>30	50
比較例 31	PP14	5. 1	160	ALK-3	60	>30	42
比較例 32	PP15	4.8	140	SAM-6	80	25	58
比較例 33	PP15	4.8	140	SAM-8	80	20	62
比較例 34	PP15	4.8	140	SAM-9	80	20	60
比較例 35	PP15	4.8	140	ALK-3	80	30	52
比較例 36	PPI6	5. 2	160	SAM-6	80	30	51
比較例 37	PPI6	5. 2	160	SAM-8	80	30	58
比較例 38	PPI6	5. 2	160	SAM-9	80	30	55
比較例 39	PP16	5. 2	160	ALK-3	80	30	50

[0158]

	* 						
【表12】 表 12							
	感光性 ポリイミド	膜厚 (µm)	感度 (nJ/cm ²)	現像液	現像時間(sec)	解像特性 (µm)	未露光部 残膜率(%)
比較例 40	PP17	4. 9	140	SAM-6	120	25	55
比較例 41	PP17	4. 9	140	SAM-8	120	20	62
比較例 42	PP17	4. 9	140	SAM-9	120	20	60
比較例 43	PP17	4. 9	140	ALK-3	120	30	52
比較例 44	PP18	5. 0	180	SAM-6	60	>30	40
比較例 45	PP18	5. 0	180	SAM-8	60	30	51
比較例 46	PP19	5.0	160	SAM-6	60	>30	33
比較例 47	PPI9	5. 0	160	SAM-8	60	30	50
比較例 48	PPI10	4.8	140	SAM-6	80	30	55
比較例 49	PPI 10	4.8	140	SAM-8	80	25	62
比較例 50	PPI11	5, 1	160	SAM-6	60	>30	40
比較例 51	PPI11	5. 1	160	SAM-8	60	30	52
比較例 52	PPI12	4.9	140	SAM-6	80	30	50
比較例 53	PPI12	1.9	140	SAM-8	80	30	57
比較例 54	PPI13	4.8	140	SAM-6	80	30	48
比較例 55	PPI13	4.8	140	SAM-8	80	30	56

[0159]

【表13】

表 13

	感光性	膜厚	感度	現像液	現像時間	解像特性	未露光部
	ポリイミド	(μm)	(mJ/cm ²)	- SCIENTX	(sec)	(µm)	残膜率(%)
比較例 56	PPI14	5. 1	160	SAM-6	60	>30	38
比較例 57	PPI 14	5. 1	160	SAM-8	60	30	49
比較例 58	PPI15	4.9	140	SAM-6	80	30	50
比較例 59	PP115	4.9	140	SAM-8	80	30	55
比較例 60	PPI16	4.8	140	SAM-6	80	30	50
比較例 61	PPI16	4. 8	140	SAM-8	80	30	57
比較例 62	PPI17	5. 1	160	SAM-6	60	>30	41
比較例 63	PPI17	5. 1	160	SAM-8	60	30	50
比較例 64	PPI18	4. 9	140	SAM-6	80	30	52
比較例 65	PPI18	4. 9	140	SAM-8	80	30	57
比較例 66	PPI19	4. 8	140	SAM-6	80	30	56
比較例 67	PPI 19	4.8	140	SAM-8	80	25	60
比較例 68	PPI20	4. 9	140	SAM-6	80	30	61
比較例 69	PPI20	4. 9	140	SAM-8	80	25	65

【0160】本発明の現像液を使用した場合(実施例8~66)は、何れも80~97%の高残膜率で4.0~8.0 μ mのライン及びスペースの微細なポジ型パターンを形成できる。これに対して、本発明のアミン化合物より強塩基性(μ Kb<5)のアミン化合物及び無機アルカリ塩を使用した現像液を使用した場合には、比較例16~69に示されているように、残膜率が33~66%で解像特性も20 μ m以上と微細なパターンは形成できなかった。

【0161】この結果から、本発明の現像液を使用することにより、感光性溶解抑止剤添加タイプのポジ型感光性ポリイミドの解像特性を大幅に改善することができ、高残膜で高解像のパターン形成できることが示唆される。

【0162】(6)電子部品の試作

更に、本発明のポリイミド膜パターン形成方法を用い、 $図1 \sim 図4$ に示す各種の電子部品を試作した。

【0163】図1は本発明のパターン形成方法により形成されたポリイミド膜パターンからなるパッシベーション膜を有する半導体素子の断面図である。ここでは実施例PPI5の感光性ポリイミド材料を用い、以下のようにしてパターン形成されたポリイミド膜をパッシベーション膜として用いた。

で樹脂層を乾燥し、プログラムオーブンで、窒素ガス雰囲気下、150℃で1時間、250℃で1時間、350 ℃で1時間加熱してポリイミドパターン膜を形成した。

【0165】図1において、タブ13上に配置されたLSIチップ11の上には、ボンディングパッド12が設けられ、更にパターニングされたポリイミド膜からなるパッシベーション膜14が形成されている。尚、LSIチップ11上のボンディングパッド12は、ボンディングワイヤ15によりリードフレーム16と接続されており、これらは封止剤17で封止されている。

【0166】本発明のパターン形成方法により得られるポリイミド膜パターンを前記パッシベーション膜14に用いれば、高信頼性の半導体素子が得られ、製造工程における不良もほとんどない。しかも、PEP工程が不要であるために製造プロセスは簡素化され、安全面等の問題も何等伴わない。

【0167】図2は本発明のパターン形成方法により形成されたポリイミド膜パターンからなる層間絶縁膜を有するマルチチップモジュールの一部を表す断面図である。ここではPPI3の感光性ポリイミド材料を用い、前述と同様の方法でパターン形成されたポリイミド膜を層間絶縁膜として用いた。

【0168】図2において、シリコン基板21上には熱酸化膜22が形成されている。この熱酸化膜22上には、銅配線23、ポリイミド膜からなる層間絶縁膜24、銅配線25及びポリイミド膜からなる層間絶縁膜26が順次形成されている。更に、上層の層間絶縁膜26の一部にコンタクトホールが開口され、銅配線23に接続するPb/Sn電極27及びBLM(Ball Limiting Metallization)28が形成されている。

【0169】上記の層間絶縁膜24及び26は感光性ポリイミドをスピンコートした後に硬化して形成するので、銅配線による段差を大幅に緩和して平坦化でき、高

信頼性の配線構造を得ることができる。

【0170】図3は本発明のパターン形成方法により形成されたポリイミド膜パターンからなるポリマーコア層を有する埋め込み型光導波路の断面図である。ここではPPI7の感光性ポリイミド材料を用い、前述と同様の方法でパターン形成されたポリイミド膜をポリマーコア層として用いた。

【0171】図3において、シリコン基板31上にはPAA8の熱硬化膜からなる下部クラッド層32が形成されている。この下部クラッド層32上には、ポリマーコア層33及びPAA8の硬化膜からなる上部クラッド層34が順次形成されている。

【0172】上記のポリマーコア層は、本発明のポリイミド膜パターン形成方法を用いることにより簡便かつ正確に形成できるので、PEP工程が不要で生産性が向上するという利点が得られる。

【0173】図4は本発明のパターン形成方法により形成されたポリイミド膜パターンからなる層間絶縁膜を有する多層配線部の半導体素子の断面図である。ここでは実施例PPI3の感光性ポリイミド材料を用い、前述と同様の方法でパターン形成されたポリイミド膜を層間絶縁膜として用いた。

【0174】図4において、素子部47が形成されたシリコン基板41表面には熱酸化膜42が形成されている。この熱酸化膜42の一部にコンタクトホールが開口され、その上に1層目のA1配線43が形成されている。このA1配線43上にポリイミド膜からなる層間絶縁膜44が形成されている。この層間絶縁膜44の一部にコンタクトホールが開口され、その上に1層目のA1配線43と接続する2層目のA1配線45が形成されている。このA1配線45上に更にポリイミド膜からなる層間絶縁膜46が形成されている。

【0175】上記の層間絶縁膜44は感光性ポリイミドをスピンコートした後に硬化して形成するので、表面の段差を緩和して平坦化した状態で多層のA1配線を形成することができ、高信頼性の配線構造を得ることができる。

[0176]

【発明の効果】以上詳述した様に、本発明の感光性ポリイミド用現像液は、感光性溶解抑止剤添加タイプの感光性ポリイミドの解像特性及び残膜特性を大幅に改善することができ、感光性ポリイミドの現像工程に本発明の感光性ポリイミド用の現像液を使用することにより、高残膜で高解像のポリイミド膜パターンを形成できるなどの優れた効果を有する。

【0177】更に、本発明のポリイミド膜パターン形成 方法によりポリイミド膜パターンを基板表面に形成する ことにより、シリコン基板やガラス基板などの素子表面 上に変質部分の無い、解像性、耐熱性、密着性に優れた ポリイミド膜を絶縁部材、保護膜部材、液晶素子部材ま たは光学素子部材として具備し、信頼性の高い電子部品を提供でき、特にLSIの配線絶縁膜、LSIの耐湿保護膜、LSIのα線遮断膜、半導体のパッシベーション膜、マルチチップモジュールの配線絶縁膜、薄膜磁気へッドの配線絶縁膜、磁気バブルメモリー素子の配線絶縁膜、光学素子、液晶素子などに有用であるなどの、顕著な効果を有する。

【0178】また、本発明の電子部品は、シリコン基板やガラス基板などの素子表面上に変質部分の無い、解像性、耐熱性、密着性に優れたポリイミド膜を絶縁部材、保護膜部材、液晶素子部材及び光学素子部材として具備し、信頼性に優れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のパターン形成方法により形成されたポリイミド膜パターンからなるパッシベーション膜を有する半導体素子の断面図。

【図2】本発明のパターン形成方法により形成されたポリイミド膜パターンからなる層間絶縁膜を有するマルチチップモジュールの断面図。

【図3】本発明のパターン形成方法により形成されたポリイミド膜パターンからなるポリマーコア層を有する光 導波路の断面図。

【図4】本発明のパターン形成方法により形成されたポリイミド膜パターンからなる層間絶縁膜を有する多層配線構造の半導体素子の断面図。

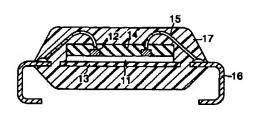
【符号の説明】

- 11…LS I チップ
- 12…ボンディングパッド
- 13…タブ
- 14…パッシベーション膜
- 15…ボンディングワイヤ
- 16…リードフレーム
- 17…封止剤
- 21…シリコン基板
- 22…熱酸化膜
- 2 3 …銅配線
- 2 4 …層間絶縁膜
- 25…銅配線
- 26…層間絶縁膜
- 27…Pb/Sn電極
- 28...BLM (Ball Limiting Metallization)
- 31…シリコン基板
- 32…下部クラッド層
- 33…ポリマーコア層
- 34…上部クラッド層
- 41…シリコン基板
- 42…熱酸化膜
- 43…1層目A1配線
- 44…層間絶縁膜
- 45…2層目A1配線

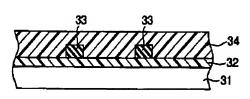
46…層間絶縁膜

4 7 …素子部

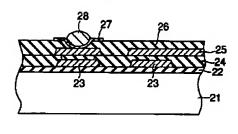
【図1】



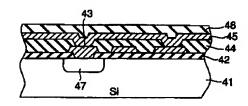
[図3]



[図2]



【図4】



フロントページの続き

(51) Int.C1.7	•	識別記号
G03F	7/022	6 0 1
	7/037	5 0 1
	7/40	5 0 1
H011	21/027	

(72)発明者 真竹 茂

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研究開発センター内

FΙ

G 0 3 F 7/022

テ-マコード(参考) 6 0 1

7/037 5 0 1 7/40 5 0 1

7/40 5 0 1 H 0 1 L 21/30 5 6 9 E

(72)発明者 御子柴 智

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内